PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication numb r:

2001-206710

(43)Date of publication of application: 31.07.2001

(51)Int.CI.

CO1B 33/12 CO9D183/00 H01L 21/312 H01L 21/316

(21)Application number: 2000-011088

(71)Applicant:

JSR CORP

(22)Date of filing:

20.01.2000

(72)Inventor:

SHIODA ATSUSHI

SHIBA TADAHIRO KUROSAWA TAKAHIKO

YAMADA KINJI

(54) FORMING METHOD OF SILICA BASE FILM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a silica based film useful as an interlaminar insulating film in a semiconductor element or the like and having low density, low dielectric constant, high elastic modulus and low water absorption. SOLUTION: The silica based film is obtained by applying a coating composition containing polysiloxane A, an organic polym r B and an organic solvent C on a substrate and after removing the organic solvent, heating the substrate at 250-400° C in an vacuum or inert gas atmosphere, next heating it at 250-400° C in an atmosphere of oxygen partial pressur not less than 1 Pa and further heating it at a temperature of 350-470° C in an atmosphere of oxygen partial pressur | ss than 1 Pa.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted r gistration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not r fl ct the original precisely.
- 2. **** shows th word which can not b translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] (A) The formation method of the silica system film characterized by heating at 250–400 degrees C under a vacuum or inert gas atmosphere, heating under the atmosphere of 1Pa or more of oxygen tension subsequently to 250–400 degrees C, and heating at 350–470 degrees C under the atmosphere of less than 1Pa of oxygen tension further after applying the coating constituent containing a polysiloxane, (B) organic polymer, and the (C) organic solvent to a substrat and removing an organic solvent.

[Claim 2] (A) The compound by which a polysiloxane is expressed with the following (A-1) general formula (1), and R1 a Si (OR2)4-a (1)

(Among a formula, R1 shows a hydrogen atom, a fluorine atom, or a univalent organic machine, R2 shows a univalent organic machine, and a expresses the integer of 0–2.)

(A-2) Th following general formula (2) Compound expressed R3 b3(R4 O)-b Si-(R7) d-Si(OR5)3-c R6 c (2) (R3, R4, R5, and R6 among a formula) even when you may differ even if the same, and a univalent organic machine is shown, respectively and b and c are the same — differing — **** — the number of 0-2 — being shown — R7 The basis xpressed with an oxygen atom or -(CH2) n- is shown, and, in n, 1-6d show 0 or 1. The formation method of the silica system film according to claim 1 which is the hydrolyzate and its condensate, or either of at least one sort of silane compounds chosen from the group.

[Claim 3] (A) The manufacture method of a silica system film according to claim 2 that a polysiloxane hydrolyzes and condenses a silane compound under existence of at least one sort of catalysts chosen from the group of a metal chelat compound, an acid compound, and an alkaline compound.

[Claim 4] (B) The manufacture method of a silica system film according to claim 1 that organic polymer is at least one sort chosen from the group of a polyether, polyester, a polycarbonate, a polyanthus hydride, and (meta) an acrylic polymer. [Claim 5] (C) The formation method of a silica system film according to claim 1 of performing removal of an organic solvent by heating a substrate at 60–250 degrees C.

[Claim 6] The formation method of a silica system film according to claim 1 that oxygen tension performs heating under atmosphere 1Pa or more for 1 minute to 2 hours.

[Claim 7] The formation method of a silica system film according to claim 1 that the atmosphere of less than 1Pa of oxygen tension is under an inert atmosphere.

[Claim 8] The formation method of a silica system film according to claim 1 that oxygen tension performs heating under less than 1Pa atmosphere for 1 minute to 3 hours.

[Translation done.]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-206710A) (P2001-206710A) (43)公開日 平成13年7月31日(2001.7.31)

(51) Int. C1. 7	識別記号		FI			テーマコード(参:	考)
C 0 1 B	33/12		C 0 1 B	33/12	C	4G072	
C 0 9 D	183/00		C 0 9 D	183/00	•	4J038	
H01L	21/312		H01L	21/312	C	5F058	
	21/316			21/316	- 0	÷	•
			•				
	審査請求 未請求 請求項の数8	OL			(全19	頁)	
(21)出顯番号	特願2000-11088(P2000-11088)		(71)出願。	人 00000417	'8		
				ジェイエ	スアールを	k式会社	
(22)出願日	平成12年1月20日(2000.1.20)		東京都中央区築地2丁目11番24号				
			(72)発明	者 塩田 淳			•
				東京都中	央区築地二	二丁目11番24号	ジェイ
				エスアー	・ル株式会社	L内	
		•	(72)発明	者 柴 唯啓	٤		
		-		東京都中	央区築地工	二丁目11番24号	ジェイ
			,	エスアー	-ル株式会社	Ł内	
•		1	(74)代理	人 10008522	24		
				弁理士	白井 重隆	<u>.</u> #	
•							
•				· ·			
•						最終	頁に続く
		l l					

(54) 【発明の名称】シリカ系膜の形成方法

(57)【要約】

【課題】 半導体素子などにおける層間絶縁膜として有用な、低密度、低誘電率、高弾性率、低吸水率のシリカ系膜を提供する。

【解決手段】 (A) ポリシロキサン、(B) 有機ポリマーおよび(C) 有機溶媒を含むコーティング組成物を基板に塗布し、有機溶媒を除去したのち、真空または不活性ガス雰囲気下で250~400℃に加熱し、次いで酸素分圧1Pa以上の雰囲気下で250~400℃に加熱し、さらに酸素分圧1Pa未満の雰囲気下で350~470℃に加熱し、シリカ系膜を得る。

【特許請求の範囲】

(A) ポリシロキサン、(B) 有機ポリ 【請求項1】 マーおよび(C)有機溶媒を含むコーティング組成物を 基板に塗布し、有機溶媒を除去したのち、真空または不 活性ガス雰囲気下で250~400℃に加熱し、次いで 酸素分圧1Pa以上の雰囲気下で250~400℃に加 熱し、さらに酸素分圧1Pa未満の雰囲気下で350~ 470℃に加熱することを特徴とするシリカ系膜の形成*

 R^{3}_{b} (R^{4} O) _{3-b} S i - (R^{7}) _d - S i (O R^{5}) _{3-c} R^{6} _c

(式中、R³, R⁴, R⁵ およびR⁶ は、同一でも異な っていてもよく、それぞれ1価の有機基を示し、bおよ びcは、同一でも異なっていてもよく、0~2の数を示 し、 R^7 は酸素原子または $-(CH_2)_n$ ーで表される 基を示し、nは1~6を、dは0または1を示す。)の 群から選ばれた少なくとも1種のシラン化合物の、加水 分解物およびその縮合物もしくはいずれか一方である請 求項1記載のシリカ系膜の形成方法。

(A) ポリシロキサンが、シラン化合物 【請求項3】 を、金属キレート化合物、酸性化合物およびアルカリ性 20 化合物の群から選ばれた少なくとも1種の触媒の存在下 に、加水分解・縮合されたものである請求項2記載のシ リカ系膜の製造方法。

【請求項4】 (B) 有機ポリマーが、ポリエーテル、 ポリエステル、ポリカーボネート、ポリアンハイドライ ドおよび (メタ) アクリル系重合体の群から選ばれた少 なくとも1種である請求項1記載のシリカ系膜の製造方

(C) 有機溶媒の除去を、基板を60~ 【請求項5】 250℃に加熱することにより行なう請求項1記載のシ 30 リカ系膜の形成方法。

酸素分圧が1Pa以上の雰囲気下での加 【請求項6】 熱を1分~2時間行なう請求項1記載のシリカ系膜の形 成方法。

酸素分圧1Pa未満の雰囲気が不活性雰 【請求項7】 囲気下である請求項1記載のシリカ系膜の形成方法。

【請求項8】 酸素分圧が1Pa未満の雰囲気下での加 熱を1分~3時間行なう請求項1記載のシリカ系膜の形 成方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、シリカ系膜の形成 方法に関し、さらに詳しくは、半導体素子などにおける 層間絶縁膜材料として、誘電率特性、吸水性特性、機械・ 的強度に優れ、低密度の硬化膜であるシリカ系膜の形成 方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、半導体素子などにおける層間絶縁 膜として、CVD法などの真空プロセスで形成されたシ リカ(SiO2)膜が多用されている。そして、近年、

*方法。

(A) ポリシロキサンが、 【請求項2】

(A-1) 下記一般式 (1) で表される化合物、および R^1 S i (OR^2) 4-a $\cdots \cdots (1)$

(式中、R1 は水素原子、フッ素原子または1価の有機 基を示し、R² は1価の有機基を示し、a は0~2の整 数を表す。)

(A-2) 下記一般式(2) で表される化合物

• (2)

より均一な層間絶縁膜を形成することを目的として、S OG (Spin on Glass) 膜と呼ばれるテト ラアルコキシランの加水分解生成物を主成分とする塗布 型の絶縁膜も使用されるようになっている。また、半導 体素子などの高集積化に伴い、有機SOGと呼ばれるポ リオルガノシロキサンを主成分とする低誘電率の層間絶 縁膜が開発されている。しかしながら、半導体素子など¹ のさらなる高集積化や多層化に伴い、より優れた導体間 の電気絶縁性が要求されており、したがって、より低誘 電率で表面硬度特性に優れる層間絶縁膜材料が求められ るようになっている。

【0003】そこで、特開平6-181201号公報に は、層間絶縁膜材料として、より低誘電率の絶縁膜形成 用塗布型組成物が開示されている。この塗布型組成物 は、吸水性が低く、耐クラック性に優れた半導体装置の 絶縁膜を提供することを目的としており、その構成は、 チタン、ジルコニウム、ニオブおよびタンタルから選ば れる少なくとも1種の元素を含む有機金属化合物と、分 子内にアルコキシ基を少なくとも1個有する有機ケイ素 化合物とを縮重合させてなる、数平均分子量が500以 上のオリゴマーを主成分とする絶縁膜形成用塗布型組成 物である。

【0004】また、WO96/00758号公報には、 多層配線基板の層間絶縁膜の形成に使用される、アルコ キシシラン類、シラン以外の金属アルコキシドおよび有 機溶媒などからなる、厚膜塗布が可能で、かつ耐酸素プ ラズマ性に優れるシリカ系塗布型絶縁膜形成用材料が開 示されている。

【0005】さらに、特開平3-20377号公報に 40 は、電子部品などの表面平坦化、層間絶縁などに有用な 酸化物被膜形成用塗布液が開示されている。この酸化物 被膜形成用塗布液は、ゲル状物の発生のない均一な塗布 液を提供し、また、この塗布液を用いることにより、高 温での硬化、酸素プラズマによる処理を行なった場合で あっても、クラックのない良好な酸化物被膜を得ること を目的としている。そして、その構成は、所定のシラン 化合物と、同じく所定のキレート化合物とを有機溶媒の 存在化で加水分解し、重合して得られる酸化物被膜形成 用塗布液である。

【0006】しかし、上記のようにシラン化合物にチタ

ンやジルコニウムなどの金属キレート化合物を組み合せ た場合、塗膜の均一性や溶液の長期保存安定性が優れ ず、さらに誘電率、表面硬度などをバランスよく有する ものではない。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記問題点 を解決するための膜形成用の組成物に関し、さらに詳し くは、例えば半導体素子などにおける層間絶縁膜とし て、誘電率特性、吸水性特性、機械的強度に優れ、低密 度の硬化膜であるシリカ系膜を提供することを目的とす 10 る。

[8000]

【課題を解決するための手段】本発明は、(A)ポリシ ロキサン、(B) 有機ポリマーおよび(C) 有機溶媒を 含むコーティング組成物を基板に塗布し、有機溶媒を除 去(以下「プレベーク」ともいう)したのち、真空また*

 R^{3}_{b} (\dot{R}^{4} O) _{3-b} S i - (R^{7}) _d - S i ($O\dot{R}^{5}$) _{3-c} R^{6}_{c}

(式中、R³, R⁴, R⁵ およびR°は、同一でも異な っていてもよく、それぞれ1価の有機基を示し、bおよ 20 浸漬法はたはスピンコート法などにより、シリコンウエ びcは、同一でも異なっていてもよく、0~2の数を示 し、 R^7 は酸素原子または $-(CH_2)_n$ -で表される 基を示し、nは1~6を、dは0または1を示す。)の 群から選ばれた少なくとも1種のシラン化合物の、加水 分解物およびその縮合物もしくはいずれか一方(以下 「(A)加水分解縮合物」ともいう)であることが好ま

しい。また、上記(A)ポリシロキサンは、シラン化合 物を、金属キレート化合物、酸性化合物およびアルカリ

性化合物の群から選ばれた少なくとも1種の触媒の存在 下に、加水分解・縮合されたものであることが好まし い。さらに、上記(B)有機ポリマーは、ポリエーテ ル、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリアンハイド ライドおよび(メタ)アクリル系重合体の群から選ばれ た少なくとも1種であることが好ましい。さらに、上記 (C) 有機溶媒の除去は、基板を60~250℃に加熱 することにより行なうことが好ましい。さらに、第2次 ソフトベークにおいて、酸素分圧が1Pa以上の雰囲気 下での加熱は、1分~2時間行なうことが好ましい。さ らに、ファイナルアニールにおいて、酸素分圧1 P a 未 満の雰囲気は、不活性雰囲気下であることが好ましい。 さらに、ファイナルアニールにおいて、酸素分圧が1P a 未満の雰囲気下での加熱は、1分~3時間行なうこと

が好ましい。 [0009]

【発明の実施の形態】本発明は、膜を形成するベースポ リマーとして(A)加水分解縮合物を、また多孔質を形 成する材料として特定の(B)有機ポリマーを用い、

(A)~(B)成分の溶剤として(C)有機溶媒を用い※

 R^{3}_{b} (R⁴ O) _{3-b} S i - (R⁷) _d - S i (OR⁵) _{3-c} R⁶ _c

*は不活性ガス雰囲気下で250~400℃に加熱(以下 「第1次ソフトベーク」ともいう) し、次いで酸素分圧 1 P a 以上の雰囲気下で2 5 0~4 0 0℃に加熱(以下 「第2次ソフトベーク」ともいう) し、さらに酸素分圧 1 P a 未満の雰囲気下で350~470℃に加熱(以下 「ファイナルアニール」ともいう) することを特徴とす るシリカ系膜の形成方法に関する。ここで、上記(A) ポリシロキサンは、

(A-1) 下記一般式(1) で表される化合物(以下 「化合物 (A-1)」ともいう)、および

 $\cdots \cdots (1)$ $R^1 = Si (OR^2)_{4-a}$

(式中、R1 は水素原子、フッ素原子または1価の有機 基を示し、 R^2 は1価の有機基を示し、aは0~2の整 数を表す。)

(A-2) 下記一般式 (2) で表される化合物 (以下 「化合物(A-2」ともいう)

• • • • (2)

※る。かくて、(A)~(C)成分を含有する組成物を、

ハなどの基材に塗布し、まず、プレベークにより基板か ら有機溶媒を除去したのち、次いで、一定の条件で、第 1次~第2次ソフトベーク、ファイナルアニール処理を 施すものである。これにより、(B) 有機ポリマーおよ び(C)有機溶媒の除去と、(A)成分の熱重縮合を行 なうと、(A)成分がガラス質または巨大高分子の膜を 形成するとともに、(B) 有機ポリマーが分解・除去さ れることにより、低密度化される。また、上記のよう な、プレベーク、ソフトベーク、ファイナルアニール処 30 理を施すことにより、機械的強度が向上し、さらに残留 揮発分の含有量の少ない膜を形成することができる。得 られるシリカ系膜は、低密度で、低誘電率を保持しつ つ、電気的絶縁性、プロセス薬液耐性、耐CMP性に優 れた膜である。

【0010】 (A) ポリシロキサン

本発明のシリカ系膜の形成方法に用いられるコーティン グ組成物を構成する(A)ポリシロキサンとしては、シ ロキサン結合(-Si-O-結合)が連鎖している縮合 体であれば、いかなるものでもよいが、下記化合物(A 40 -1) および (A-2) もしくはいずれか一方の、加水 分解縮合物が好ましい。化合物(A-1);下記一般式 (1)で表される化合物

 R^1 s i (OR^2) 4-a • • • • • (1)

(式中、R1 は水素原子、フッ素原子または1価の有機 基を示し、R² は1価の有機基を示し、aは0~2の整 数を表す。)

・ 化合物 (A-2);下記一般式 (2) で表される化合物

(式中、 R^3 , R^4 , R^6 および R^6 は、同一でも異なっていてもよく、それぞれ1価の有機基を示し、bおよびcは、同一でも異なっていてもよく、 $0\sim2$ の数を示し、 R^7 は酸素原子または $-(CH_2)_n$ 一で表される基を示し、nは $1\sim6$ を、dは0または1を示す。)

【0011】ここで、シリカ系膜を形成するベースポリマーとして、化合物(A-1)および化合物(A-2)もしくはいずれか一方の、加水分解縮合物 [(A) ポリシロキサン]を用い、これと(B) 有機ポリマーおよび(C) 有機溶媒を含む組成物を、浸漬法またはスピンコ 10ート法などにより、シリコンウエハなどの基材に塗布し、加熱処理(プレベーク、第1次~第2次ソフトベーク、およびファイナルアニール処理)すると、上記

(A) 加水分解縮合物の熱重縮合と平行して、(B) 有機ポリマーの分解が生起し、(A) 成分がガラス質または巨大高分子の膜を形成し、得られる膜は、低密度、低吸水性、低誘電率、機械的強度に優れた層間絶縁膜材料を形成することができる。

【0012】ここで、本発明において、加水分解とは、上記(A)成分を構成する化合物(A-1)~(A-202)に含まれるR²O-基,R⁴O-基およびR⁵O-基がすべてが加水分解されている必要はなく、例えば1個だけが加水分解されているもの、2個以上が加水分解されているもの、3個以上が加水分解されているもの、あるいは、これらの混合物が生成することである。また、本発明において、縮合とは、(A)成分を構成する加水分解物のシラノール基が縮合してSi-O-Si結合を形成したものであるが、本発明では、シラノール基がすべて縮合している必要はなく、僅かな一部のシラノール基が縮合したもの、縮合の程度が異なっているものの混合物などをも生成することを包含30した概念である。

【0013】本発明において、(A)成分は、上記化合物(A-1)および(A-2)もしくはいずれか一方が、(共)加水分解・縮合してなる加水分解縮合物である。

化合物(A-1);上記一般式(1)において、R¹ およびR² の1価の有機基としては、アルキル基、アリール基、アリル基、グリシジル基などを挙げることができる。また、一般式(1)において、R¹ は1価の有機基、特にアルキル基またはフェニル基であることが好ま 40しい。ここで、アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基などが挙げられ、好ましくは炭素数1~5であり、これらのアルキル基は鎖状でも、分岐していてもよく、さらに水素原子がフッ素原子などに置換されていてもよい。一般式(1)において、アリール基としては、フェニル基、ナフチル基、メチルフェニル基、エチルフェニル基、クロロフェニル基、ブロモフェニル基、フルオロフェニル基などを挙げることができる。

【0014】一般式(1)で表される化合物の具体例と 50 cープチルトリメトキシシラン、secープチルーiー

しては、トリメトキシシラン、トリエトキシシラン、トリーロープロポキシシラン、トリーローブトキシシラン、トリーsecーブトキシシラン、トリーローブトキシシラン、トリーをローブトキシシラン、フルオロトリメトキシシラン、フルオロトリーロープロポキシシラン、フルオロトリーロープロポキシシラン、フルオロトリーローブトキシシラン、フルオロトリーローブトキシシラン、テトラーローブトキシシラン、テトラーローブトキシシラン、テトラーローブトキシシラン、テトラーローブトキシシラン、テトラーローブトキシシラン、テトラーローブトキシシラン、テトラーローブトキシシラン、テトラーローブトキシシラン、テトラーローブトキシラン、テトラーローブトキシラン、テトラーをローブトキシラン、テトラーローブトキシラン、テトラーローブトキシラン、テトラーローブトキシラン、テトラーローブトキシラン、テトラーローブトキシランなど:

【0015】メチルトリメトキシシラン、メヂルトリエ トキシシラン、メチルトリーnープロポキシシラン、メ チルトリーiso-プロポキシシラン、メチルトリーn ープトキシシラン、メチルトリーsecープトキシシラ 20 ン、メチルトリーtert-ブトキシシラン、メチルト リフェノキシシラン、エチルトリメトキシシラン、エチ ルトリエトキシシラン、エチルトリーnープロポキシシ ラン、エチルトリーisoープロポキシシラン、エチル トリーnーブトキシシラン、エチルトリーsecーブト キシシラン、エチルトリーtert-ブトキシシラン、 エチルトリフェノキシシラン、ビニルトリメトキシシラ ン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリーnープロ ポキシシラン、ビニルトリーisoープロポキシシラ ン、ビニルトリーnープトキシシラン、ビニルトリーs ecーブトキシシラン、ビニルトリーtertーブトキ シシラン、ビニルトリフェノキシシラン、nープロピル トリメトキシシラン、n-プロピルトリエトキシシラ ン、nープロピルトリーnープロポキシシラン、nープ ロピルトリーisoープロポキシシラン、nープロピル トリーnープトキシシラン、nープロピルトリーsec ーブトキシシラン、nープロピルトリーtertープト キシシラン、nープロピルトリフェノキシシラン、iー プロピルトリメトキシシラン、i-プロピルトリエトキ シシラン、iープロピルトリーnープロポキシシラン、 i-プロピルトリーiso-プロポキシシラン、i-プ ロピルトリーnーブトキシシラン、iープロピルトリー secーブトキシシラン、iープロピルトリーtert ープトキシシラン、 i ープロピルトリフェノキシシラ ン、nープチルトリメトキシシラン、nープチルトリエ トキシシラン、nープチルトリーnープロポキシシラ ン、nープチルトリーisoープロポキシシラン、nー プチルトリーnープトキシシラン、nープチルトリーs ecープトキシシラン、nープチルトリーtertープ トキシシラン、nープチルトリフェノキシシラン、se

トリエトキシシラン、secーブチルートリーnープロ ポキシシラン、sec-ブチルートリーiso-プロポ キシシラン、sec-ブチルートリーn-ブトキシシラ ン、sec-ブチルートリーsec-ブトキシシラン、 secーブチルートリーtertーブトキシシラン、s・ e c ープチルートリフェノキシシラン、tープチルトリ メトキシシラン、tープチルトリエトキシシラン、tー ブチルトリーnープロポキシシラン、tーブチルトリー iso-プロポキシシラン、t-ブチルトリーn-ブト キシシラン、 t ーブチルトリー s e c ーブトキシシラ ン、tープチルトリーtertープトキシシラン、tー ブチルトリフェノキシシラン、フェニルトリメトキシシ ラン、フェニルトリエトキシシラン、フェニルトリーn ープロポキシシラン、フェニルトリーisoープロポキ シシラン、フェニルトリーnーブトキシシラン、フェニ ルトリーsecープトキシシラン、フェニルトリーte rtープトキシシラン、フェニルトリフェノキシシラ ン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシ ラン、y-アミノプロピルトリメトキシシラン、y-ア ミノプロピルトリエトキシシラン、ャーグリシドキシプ 20 ロピルトリメトキシシラン、ソーグリシドキシプロピル トリエトキシシラン、ャートリフロロプロピルトリメト キシシラン、ャートリフロロプロピルトリエトキシシラ ンなど;

【0016】ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエ トキシシラン、ジメチルージーnープロポキシシラン、 ジメチルージーiso-プロポキシシラン、ジメチルー ジーnーブトキシシラン、ジメチルージーsecーブト キシシラン、ジメチルージーtert-ブトキシシラ ン、ジメチルジフェノキシシラン、ジエチルジメトキシ 30 シラン、ジエチルジエトキシシラン、ジエチルージーn ープロポキシシラン、ジエチルージーisoープロポキ シシラン、ジエチルージーnーブトキシシラン、ジエチ ルージーsecープトキシシラン、ジエチルージーte rtープトキシシラン、ジエチルジフェノキシシラン、 ジーnープロピルジメトキシシラン、ジーnープロピル ジエトキシシラン、ジーn-プロピルージーn-プロポ キシシラン、ジーnープロピルージーisoープロポキ シシラン、ジーnープロピルージーnーブトキシシラ ン、ジーnープロピルージーsecーブトキシシラン、 ジーnープロピルージーtertープトキシシラン、ジ ーnープロピルージーフェノキシシラン、ジーiso-プロピルジメトキシシラン、ジーiso-プロピルジエ トキシシラン、ジーisoープロピルージーnープロポ キシシラン、ジーiso-プロピルージーiso-プロ ポキシシラン、ジーiso-プロピルージーn-ブトキ シシラン、ジーisoープロピルージーsecーブトキ シシラン、ジーisoープロピルージーtertーブト キシシラン、ジーiso-プロピルージーフェノキシシ ラン、ジーn-プチルジメトキシシラン、ジーn-プチ 50

ルジエトキシシラン、ジーnープチルージーnープロポ キシシラン、ジーnーブチルージーisoープロポキシ シラン、ジーnーブチルージーnーブトキシシラン、ジ ーnープチルージーsecープトキシシラン、ジーnー プチルージーtertープトキシシラン、ジーnーブチ ルージーフェノキシシラン、ジーsecーブチルジメト キシシラン、ジーsecーブチルジエトキシシラン、ジ -sec-ブチルージーn-プロポキシシラン、ジーs e c ーブチルージーisoープロポキシシラン、ジーs e c ープチルージーn ープトキシシラン、ジーsec-プチルージーsecープトキシシラン、ジーsecープ チルージーtertーブトキシシラン、ジーsecーブ チルージーフェノキシシラン、ジーtertープチルジ メトキシシラン、ジーtert-ブチルジエトキシシラ ン、ジーtertープチルージーnープロポキシシラ ン、ジーtertープチルージーisoープロポキシシ ラン、ジーtertーブチルージーnープトキシシラ ン、ジーtertーブチルージーsecーブトキシシラ ン、ジーtertーブチルージーtertーブトキシシ ラン、ジーtertープチルージーフェノキシシラン、 ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニルージーエトキ シシラン、ジフェニルージーnープロポキシシラン、ジ フェニルージーisoープロポキシシラン、ジフェニル ージーnーブトキシシラン、ジフェニルージーsecー ブトキシシラン、ジフェニルージー tertープトキシ シラン、ジフェニルジフェノキシシラン、ジビニルトリ メトキシシラン、ソーアミノプロピルトリメトキシシラ ン、ァーアミノプロピルトリエトキシシラン、ァーグリ シドキシプロピルトリメトキシシラン、ャーグリシドキ シプロピルトリエトキシシラン、ソートリフロロプロピ ルトリメトキシシラン、ァートリフロロプロピルトリエ トキシシランなど;を挙げることができる。

8

【0017】好ましくは、テトラメトキシシラン、テト ラエトキシシラン、テトラ-n-プロポキシシラン、テ トラーiso-プロポキシシラン、テトラフェノキシシ ラン、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシ シラン、メチルトリーnープロポキシシラン、メチルト リーiso-プロポキシシラン、エチルトリメトキシシ ラン、エチルトリエトキシシラン、ビニルトリメトキシ シラン、ビニルトリエトキシシラン、フェニルトリメト キシシラン、フェニルトリエトキシシラン、ジメチルジ メトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、ジエチル ジメトキシシラン、ジエチルジエトキシシラン、ジフェ ニルジメトキシシラン、ジフェニルジエトキシシラン、 トリメチルモノメトキシシラン、トリメチルモノエトキ シシラン、トリエチルモノメトキシシラン、トリエチル モノエトキシシラン、トリフェニルモノメトキシシラ ン、トリフェニルモノエトキシシランである。これら は、1種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。

【0018】化合物(A-2);上記一般式 (2) にお

いて、1価の有機基としては、先の一般式(1)と同様 な有機基を挙げることができる。また、一般式 (2) の R⁷である2価の有機基としては、メチレン基、炭素数 2~6のアルキレン基などを挙げることができる。一般 式 (2) のうち、 R^7 が酸素原子の化合物としては、 $^{\circ}$ キサメトキシジシロキサン、ヘキサエトキシジシロキサ ン、ヘキサフェノキシジシロキサン、1, 1, 1, 3, 3-ペンタメトキシー3-メチルジシロキサン、1, 1, 1, 3, 3ーペンタエトキシー3ーメチルジシロキ サン、1, 1, 1, 3, 3ーペンタメトキシー3ーフェ 10 ルジシラン、1, 2ージメトキシー1, 1, 2, 2ーテ ニルジシロキサン、1, 1, 1, 3, 3ーペンタエトキ シー3-フェニルジシロキサン、1,1,3,3-テト ラメトキシー1、3ージメチルジシロキサン、1、1、 3, 3-テトラエトキシー1, 3-ジメチルジシロキサ ン、1、1、3、3ーテトラメトキシー1、3ージフェ ニルジシロキサン、1,1,3,3-テトラエトキシー 1、3-ジフェニルジシロキサン、1、1、3-トリメ トキシー1、3、3ートリメチルジシロキサン、1、 1、3-トリエトキシー1、3、3-トリメチルジシロ キサン、1、1、3ートリメトキシー1、3、3ートリ フェニルジシロキサン、1,1,3ートリエトキシー。 1, 3, 3-トリフェニルジシロキサン、1, 3-ジメ トキシー1, 1, 3, 3ーテトラメチルジシロキサン、 1, 3-ジエトキシー1, 1, 3, 3-テトラメチルジ シロキサン、1, 3-ジメトキシー1, 1, 3, 3-テ トラフェニルジシロキサン、1,3-ジエトキシー1, 1, 3, 3-テトラフェニルジシロキサンなどを挙げる ことができる。

【0019】これらのうち、ヘキサメトキシジシロキサ ン、ヘキサエトキシジシロキサン、1,1,3,3-テ 30 トラメトキシー1、3-ジメチルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テトラエトキシー1, 3-ジメチルジシロ キサン、1, 1, 3, 3-テトラメトキシー1, 3-ジ フェニルジシロキサン、1、3-ジメトキシー1、1、 3, 3-テトラメチルジシロキサン、1, 3-ジエトキ シー1, 1, 3, 3ーテトラメチルジシロキサン、1, 3-ジメトキシー1, 1, 3, 3-テトラフェニルジシ ロキサン、1, 3-ジエトキシ-1, 1, 3, 3-テト ラフェニルジシロキサンなどを、好ましい例として挙げ ることができる。

【0020】また、一般式(2)において、dが0の化 合物としては、ヘキサメトキシジシラン、ヘキサエトキ シジシラン、ヘキサフェノキシジシラン、1,1,1, 2, 2-ペンタメトキシー2-メチルジシラン、1, 1, 1, 2, 2ーペンタエトキシー2ーメチルジシラ ン、1, 1, 1, 2, 2ーペンタメトキシー2ーフェニ ルジシラン、1, 1, 1, 2, 2-ペンタエトキシー2 ーフェニルジシラン、1,1,2,2ーテトラメトキシ -1、2-ジメチルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラ ェトキシ-1, 2-ジメチルジシラン、1, 1, 2, 2 50 1, 2-ジフェニルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラ

ーテトラメトキシー1,2-ジフェニルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラエトキシー1, 2-ジフェニルジシ ラン、1,1;2ートリメトキシー1,2,2ートリメ チルジシラン、1, 1, 2-トリエトキシー1, 2, 2 ートリメチルジシラン、1,1,2ートリメトキシー 1, 2, 2ートリフェニルジシラン、1, 1, 2ートリ エトキシー1, 2, 2ートリフェニルジシラン、1, 2 ージメトキシー1、1、2、2ーテトラメチルジシラ ン、1, 2-ジエトキシー1, 1, 2, 2ーテトラメチ トラフェニルジシラン、1,2-ジエトキシー1,1, 2. 2-テトラフェニルジシランなどを挙げることがで きる。

10

【0021】さらに、一般式 (2) において、R⁷ がー (CH₂)_nーで表される基の化合物としては、ビス (ヘキサメトキシシリル) メタン、ビス (ヘキサエトキ シシリル) メタン、ビス(ヘキサフェノキシシリル)メ タン、ビス (ジメトキシメチルシリル) メタン、ビス (ジエトキシメチルシリル) メタン、ビス (ジメトキシ フェニルシリル) メタン、ビス (ジエトキシフェニルシ リル) メタン、ビス (メトキシジメチルシリル) メタ ン、ビス (エトキシジメチルシリル) メタン、ビス (メ トキシジフェニルシリル) メタン、ビス (エトキシジフ ェニルシリル)メタン、ビス(ヘキサメトキシシリル) エタン、ビス(ヘキサエトキシシリル)エタン、ビス (ヘキサフェノキシシリル) エタン、ビス (ジメトキシ メチルシリル) エタン、ビス (ジエトキシメチルシリ ル) エタン、ビス (ジメトキシフェニルシリル) エタ ン、ビス(ジエトキシフェニルシリル)エタン、ビス (メトキシジメチルシリル) エタン、ビス (エトキシジ) メチルシリル) エタン、ビス (メトキシジフェニルシリ ル) エタン、ビス (エトキシジフェニルシリル) エタ ン、1,3-ビス(ヘキサメトキシシリル)プロパン、 1, 3-ビス(ヘキサエトキシシリル)プロパン、1, 3ービス(ヘキサフェノキシシリル)プロパン、1,3 ービス (ジメトキシメチルシリル) プロパン、1,3-ビス (ジエトキシメチルシリル) プロパン、1,3-ビ ス (ジメトキシフェニルシリル) プロパン、1,3ービ ス (ジエトキシフェニルシリル) プロパン、1,3ービ 40 ス (メトキシジメチルシリル) プロパン、1,3-ビス (エトキシジメチルシリル) プロパン、1, 3ービス (メトキシジフェニルシリル) プロパン、1,3-ビス (エトキシジフェニルシリル) プロパンなどを挙げるこ とができる。

【0022】これらのうち、ヘキサメトキシジシラン、 ヘキサエトキシジシラン、ヘキサフェノキシジシラン、 1, 1, 2, 2-テトラメトキシー1, 2-ジメチルジ シラン、1, 1, 2, 2ーテトラエトキシー1, 2ージ メチルジシラン、1, 1, 2, 2ーテトラメトキシー

エトキシー1, 2-ジフェニルジシラン、1, 2-ジメ トキシ-1, 1, 2, 2-テトラメチルジシラン、1, 2-ジエトキシー1, 1, 2, 2-テトラメチルジシラ ン、1, 2-ジメトキシー1, 1, 2, 2-テトラフェ ニルジシラン、1, 2-ジエトキシー1, 1, 2, 2-テトラフェニルジシラン、ビス (ヘキサメトキシシリ ル) メタン、ビス (ヘキサエトキシシリル) メタン、ビ ス (ジメトキシメチルシリル) メタン、ビス (ジエトキ シメチルシリル) メタン、ビス (ジメトキシフェニルシ リル) メタン、ビス (ジエトキシフェニルシリル) メタ 10 ン、ビス (メトキシジメチルシリル) メタン、ビス (エ トキシジメチルシリル) メタン、ビス (メトキシジフェ ニルシリル)メタン、ビス (エトキシジフェニルシリ ル) メタンを、好ましい例として挙げることができる。 本発明において、(A)成分としては、上記化合物(A -1)を使用することが好ましく、特に一般式(1)に おいて、a=0の化合物およびa=1の化合物を併用す ることが好ましい。

【0023】なお、上記(A)成分を構成する化合物。 (A-1) ~ (A-2) を加水分解、縮合させる際に、 R² O-基, R⁴ O-基およびR⁵ O-基の総量1モル 当たり、0.25~3モルの水を用いることが好まし く、0.3~2.5モルの水を加えることが特に好まし い。添加する水の量が0.25~3モルの範囲内の値で あれば、塗膜の均一性が低下する恐れが無く、また、加 水分解および縮合反応中のポリマーの析出やゲル化の恐 れが少ないためである。

【0024】また、(A)成分を構成する化合物(A-1)~(A-2)を加水分解、縮合させる際には、触媒 を使用してもよい。この際に使用する触媒としては、金 30 属キレート化合物、酸性化合物(有機酸,無機酸)、ア ルカリ性化合物(有機塩基,無機塩基)を挙げることが できる。なお、(A) ポリオルガノシロキサンとして は、化合物 (A-1) および (A-2) もしくはいずれ か一方を、触媒の少なくとも1種、すなわち金属キレー ト化合物、酸性化合物またはアルカリ性化合物にいずれ かの触媒を用いて、加水分解・縮合して調製し、これに 他の触媒で調製した他の(A)成分を併用してもよい。 【0025】金属キレート化合物としては、例えば、ト リエトキシ・モノ(アセチルアセトナート)チタン、ト 40 チルアセトナート)ジルコニウム、トリーiープロポキ リーn-プロポキシ・モノ(アセチルアセトナート)チ タン、トリーiープロポキシ・モノ(アセチルアセトナ ート) チタン、トリーn-プトキシ・モノ(アセチルア セトナート) チタン、トリーsecーブトキシ・モノ (アセチルアセトナート) チタン、トリーtープトキシ ・モノ (アセチルアセトナート) チタン、ジエトキシ・ ビス (アセチルアセトナート) チタン、ジーn-プロポ ・ キシ・ビス (アセチルアセトナート) チタン、ジーiー プロポキシ・ビス (アセチルアセトナート) チタン、ジ -n-プトキシ・ピス (アセチルアセトナート) チタ

ン、ジーsecープトキシ・ビス(アセチルアセトナー ト) チタン、ジー t ーブトキシ・ビス (アセチルアセト ナート) チタン、モノエトキシ・トリス (アセチルアセ トナート) チタン、モノーnープロポキシ・トリス (ア セチルアセトナート) チタン、モノーiープロポキシ・ トリス (アセチルアセトナート) チタン、モノーnープ トキシ・トリス (アセチルアセトナート) チタン、モノ -sec-ブトキシ・トリス (アセチルアセトナート) チタン、モノー t ーブトキシ・トリス (アセチルアセト ナート) チタン、テトラキス (アセチルアセトナート) チタン、トリエトキシ・モノ(エチルアセトアセテー ト) チタン、トリーnープロポキシ・モノ (エチルアセ トアセテート) チタン、トリーi-プロポキシ・モノ (エチルアセトアセテート) チタン、トリーnーブトキ シ・モノ (エチルアセトアセテート) チタン、トリーs e c - ブトキシ・モノ (エチルアセトアセテート) チタ ン、トリー t ープトキシ・モノ (エチルアセトアセテー ト) チタン、ジエトキシ・ビス (エチルアセトアセテー ト) チタン、ジーn-プロポキシ・ビス (エチルアセト 20 アセテート) チタン、ジーi-プロポキシ・ビス (エチ ルアセトアセテート) チタン、ジ-n-プトキシ・ビス (エチルアセトアセテート) チタン、ジーsecープト キシ・ビス (エチルアセトアセテート) チタン、ジー t ープトキシ・ビス (エチルアセトアセテート) チタン、 モノエトキシ・トリス (エチルアセトアセテート) チタ ン、モノーnープロポキシ・トリス(エチルアセトアセ テート) チタン、モノーi-プロポキシ・トリス (エチ ルアセトアセテート) チタン、モノーn-プトキシ・ト リス (エチルアセトアセテート) チタン、モノーsec ープトキシ・トリス (エチルアセトアセテート) チタ ン、モノー t ープトキシ・トリス (エチルアセトアセテ ート) チタン、テトラキス (エチルアセトアセテート) チタン、モノ (アセチルアセトナート) トリス (エチル アセトアセテート) チタン、ビス (アセチルアセトナー ト) ビス (エチルアセトアセテート) チタン、トリス (アセチルアセトナート) モノ (エチルアセトアセテー ト) チタンなどのチタンキレート化合物; 【0026】トリエトキシ・モノ(アセチルアセトナー ト) ジルコニウム、トリーnープロポキシ・モノ (アセ

12

シ・モノ (アセチルアセトナート) ジルコニウム、トリ -n-ブトキシ・モノ (アセチルアセトナート) ジルコ ニウム、トリーsecープトキシ・モノ (アセチルアセ トナート) ジルコニウム、トリーtープトキシ・モノ (アセチルアセトナート) ジルコニウム、ジエトキシ・ ビス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、ジーn-プロポキシ・ビス (アセチルアセトナート) ジルコニウ ム、ジーi-プロポキシ・ビス (アセチルアセトナー ト) ジルコニウム、ジ-n-プトキシ・ビス (アセチル 50 アセトナート) ジルコニウム、ジーsecープトキシ・

ビス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、ジーtー ブトキシ・ビス (アセチルアセトナート) ジルコニウ ム、モノエトキシ・トリス(アセチルアセトナート)ジ ルコニウム、モノーnープロポキシ・トリス(アセチル アセトナート) ジルコニウム、モノー i ープロポキシ・ トリス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、モノー n-プトキシ・トリス (アセチルアセトナート) ジルコ ニウム、モノーsec-ブトキシ・トリス(アセチルア セトナート) ジルコニウム、モノー t ープトキシ・トリ ス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、テトラキス 10 (アセチルアセトナート) ジルコニウム、トリエトキシ ・モノ (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、トリ -n-プロポキシ・モノ (エチルアセトアセテート) ジ ルコニウム、トリーiープロポキシ・モノ(エチルアセ トアセテート) ジルコニウム、トリーnーブトキシ・モ ノ (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、トリー s e c - プトキシ・モノ (エチルアセトアセテート) ジル コニウム、トリー t ープトキシ・モノ(エチルアセトア セテート) ジルコニウム、ジエトキシ・ビス (エチルア セトアセテート) ジルコニウム、ジーn-プロポキシ・ ビス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、ジー i ープロポキシ・ビス (エチルアセトアセテート) ジルコ ニウム、ジーロープトキシ・ビス(エチルアセトアセテ ート) ジルコニウム、ジーsecーブトキシ・ビス (エ チルアセトアセテート) ジルコニウム、ジーtーブトキ シ・ビス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、モ ノエトキシ・トリス (エチルアセトアセテート) ジルコ ニウム、モノーnープロポキシ・トリス(エチルアセト アセテート) ジルコニウム、モノーiープロポキシ・ト リス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、モノー 30 n-ブトキシ・トリス (エチルアセトアセテート) ジル コニウム、モノーsecーブトキシ・トリス (エチルア セトアセテート) ジルコニウム、モノー t ープトキシ・ トリス'(エチルアセトアセテート)ジルコニウム、テト ラキス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、モノ (アセチルアセトナート) トリス (エチルアセトアセテ ート)ジルコニウム、ビス(アセチルアセトナート)ビ ス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、トリス (アセチルアセトナート) モノ (エチルアセトアセテー ト) ジルコニウムなどのジルコニウムキレート化合物; 【0027】トリス(アセチルアセトナート)アルミニ ウム、トリス (エチルアセトアセテート) アルミニウム などのアルミニウムキレート化合物;などを挙げること ができる。

【0028】有機酸としては、例えば、酢酸、プロピオ ン酸、ブタン酸、ペンタン酸、ヘキサン酸、ヘプタン 酸、オクタン酸、ノナン酸、デカン酸、シュウ酸、マレ イン酸、メチルマロン酸、アジピン酸、セバシン酸、没 食子酸、酪酸、メリット酸、アラキドン酸、シキミ酸、 2ーエチルヘキサン酸、オレイン酸、ステアリン酸、リ 50 ングリコールーポリエチレングリコールブロックコポリ

ノール酸、リノレイン酸、サリチル酸、安息香酸、p-アミノ安息香酸、pートルエンスルホン酸、ベンゼンス ルホン酸、モノクロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ 酢酸、トリフルオロ酢酸、ギ酸、マロン酸、スルホン 酸、フタル酸、フマル酸、クエン酸、酒石酸などを挙げ ることができる。無機酸としては、例えば、塩酸、硝 酸、硫酸、フッ酸、リン酸などを挙げることができる。 【0029】有機塩基としては、例えば、ピリジン、ピ ロール、ピペラジン、ピロリジン、ピペリジン、ピコリ ン、トリメチルアミン、トリエチルアミン、モノエタノ ールアミン、ジエタノールアミン、ジメチルモノエタノ ールアミン、モノメチルジエタノールアミン、トリエタ ノールアミン、ジアザビシクロオクラン、ジアザビシク ロノナン、ジアザビシクロウンデセン、テトラメチルア ンモニウムハイドロオキサイドなどを挙げることができ る。無機塩基としては、例えば、アンモニア、水酸化ナ

14 .

【0030】これら触媒のうち、有機塩基、無機塩基、 有機酸、無機酸が好ましく、より好ましくは、有機酸、 無機塩基を挙げることができる。有機酸としては、特に 酢酸、シュウ酸、マレイン酸、マロン酸が好ましい。こ れらの触媒は、1種あるいは2種以上を同時に使用して もよい。

トリウム、水酸化カリウム、水酸化バリウム、水酸化カ

ルシウムなどを挙げることができる。

【0031】上記触媒の使用量は、化合物(A-1)~ (A-2) に含まれるR² O-基, R⁴ O-基およびR 5 〇一基の総量1モルに対して、通常、0.00001 ~0.05モル、好ましくは0.00001~0.01 モルである。

【0032】(A)成分の分子量は、GPC(屈折率, 粘度,光散乱測定)法による重量平均分子量で、好まし くは500~1,000万、さらに好ましくは700~ 900万、特に好ましくは1,000~800万であ る。500未満では、塗膜の均一性が低下する場合があ

【0033】 (B) 有機ポリマー

(B) 成分は、ポリエーテル、ポリエステル、ポリカー ボネート、ポリアンハイドライド、および (メタ) アク リル系重合体の群から選ばれた少なくとも1種である。 40 【0034】このうち、(B) 成分を構成するポリエー テルとしては、繰り返し単位中の炭素数が2~12のポ リアルキレングリコール化合物を挙げることができ、例 えば、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコ ール、ポリトリメチレングリコール、ポリテトラメチレ ングリコール、ポリペンタメチレングリコール、ポリヘ キサメチレングリコール、ポリエチレングリコールーポ リプロピレングリコールプロックコポリマー、ポリエチ レングリコールーポリテトラメチレングリコールブロッ クコポリマー、ポリエチレングリコールーポリプロピレ

マー、およびそのメチルエーテル、エチルエーテル、プ ロピルエーテル、トリメトキシシリルエーテル、トリエ トキシシリルエーテル、トリプロポキシシリルエーテ ル、トリメトキシシリルメチルエーテル、トリエトキシ シリルメチルエーテル、2-トリメトキシシリルエチル エーテル、2-トリエトキシシリルエチルエーテル、3 ートリメトキシシリルプロピルエーテル、3ートリエト キシシリルプロピルエーテルなどのほか、ポリエチレン グリコールモノペンチルエーテル、ポリエチレングリコ ールモノヘキシルエーテル、ポリエチレングリコールモ 10 ノペプチルエーテル、ポリエチレングリコールモノオク チルエーテル、ポリエチレングリコールモノノニルエー テル、ポリエチレングリコールモノデカニルエーテル、 ポリエチレングリコールモノウンデカニルエーテル、ポ リエチレングリコールモノドデカニルエーテル、ポリエ チレングリコールモノトリデカニルエーテル、ポリエチ レングリコールモノテトラデカニルエーテル、ポリエチ レングリコールモノペンタデカニルエーテル、ポリエチ レングリコールモノヘキサデカニルエーテル、ポリエチ レングリコールモノヘプタデカニルエーテル、ポリエチ 20 レングリコールモノオクタデカニルエーテル、ポリエチ レングリコールモノノナデカニルエーテル、ポリエチレ ングリコールモノイコサニルエーテル、ポリエチレング リコールモノヘニコサニルエーテル、ポリエチレングリ コールモノドコサニルエーテル、ポリエチレングリコー ルモノトリコサニルエーテル、ポリエチレングリコール モノテトラコサニルエーテル、ポリエチレングリコール モノペンタコサニルエーテル、ポリエチレングリコール モノヘキサコサニルエーテル、ポリエチレングリコール モノヘプタコサニルエーテル、ポリエチレングリコール 30 モノオクタコサニルエーテル、ポリエチレングリコール モノノナコサニルエーテル、ポリエチレングリコールモ ノトリアコンタニルエーテルなどのポリエチレングリコ ールアルキルエーテル類およびそのメチルエーテル、エ チルエーテル、プロピルエーテル、トリメトキシシリル エーテル、トリエトキシシリルエーテル、トリプロポキ シシリルエーテル、トリメトキシシリルメチルエーテ ル、トリエトキシシリルメチルエーテル、2-トリメト キシシリルエチルエーテル、2-トリエトキシシリルエ チルエーテル、3-トリメトキシシリルプロピルエーテ 40 モノトリデカン酸エステル、ポリエチレングリコールモ ル、3-トリエトキシシリルプロピルエーテルなどのポ リエチレングリコールアルキルエーテル誘導体:

【0035】ポリエチレングリコールモノーpーメチル フェニルエーテル、ポリエチレングリコールモノーロー エチルフェニルエーテル、ポリエチレングリコールモノ -p-プロピルフェニルエーテル、ポリエチレングリコ ールモノーpープチルフェニルエーテル、ポリエチレン グリコールモノーpーペンチルフェニルエーテル、ポリ エチレングリコールモノーpーヘキシルフェニルエーテ ル、ポリエチレングリコールモノーp-ペプチルフェニ 50 酸エステル、ポリエチレングリコールモノテトラコサン

ルエーテル、ポリエチレングリコールモノーpーオクチ ルフェニルエーテル、ポリエチレングリコールモノーp ·-ノニルフェニルエーテル、ポリエチレングリコールモ ノーpーデカニルフェニルエーテル、ポリエチレングリ コールモノ-p-ウンデカニルフェニルエーテル、ポリ エチレングリコールモノーpードデカニルフェニルエー テル、ポリエチレングリコールモノーp-トリデカニル フェニルエーテル、ポリエチレングリコールモノーロー テトラデカニルフェニルエーテル、ポリエチレングリコ ールモノーpーペンタデカニルフェニルエーテル、ポリ エチレングリコールモノー p ーヘキサデカニルフェニル エーテル、ポリエチレングリコールモノー p ーヘプタデ カニルフェニルエーテル、ポリエチレングリコールモノ -p-オクタデカニルフェニルエーテル、ポリエチレン グリコールモノーpーノナデカニルフェニルエーテル、 ポリエチレングリコールモノーp-イコサニルフェニル エーテル、ポリエチレングリコールモノー p - ヘニコサ ニルフェニルエーテル、ポリエチレングリコールモノー pードコサニルフェニルエーテル、ポリエチレングリコ ールモノーpートリコサニルフェニルエーテル、ポリエ チレングリコールモノーp-テトラコサニルフェニルエ ーテルなどのポリエチレングリコール-p-アルキルフ エニルエーテル類およびそのメチルエーテル、エチルエ ーテル、プロピルエーテル、トリメトキシシリルエーテ ル、トリエトキシシリルエーテル、トリプロポキシシリ ルエーテル、トリメトキシシリルメチルエーテル、トリ エトキシシリルメチルエーデル、2-トリメトキシシリ ルエチルエーテル、2-トリエトキシシリルエチルエー テル、3-トリメトキシシリルプロピルエーテル、3-トリエトキシシリルプロピルエーテルなどのポリエチレ ングリコール-p-アルキルフェニルエーテル誘導体; 【0036】ポリエチレングリコールモノペンタン酸エ ステル、ポリエチレングリコールモノヘキサン酸エステ ル、ポリエチレングリコールモノヘプタン酸エステル、 ポリエチレングリコールモノオクタン酸エステル、ポリ エチレングリコールモノノナン酸エステル、ポリエチレ ングリコールモノデカン酸エステル、ポリエチレングリ コールモノウンデカン酸エステル、ポリエチレングリコ ールモノドデカン酸エステル、ポリエチレングリコール ノテトラデカン酸エステル、ポリエチレングリコールモ ノペンタデカン酸エステル、ポリエチレングリコールモ ノヘキサデカン酸エステル、ポリエチレングリコールモ ノヘプタデカン酸エステル、ポリエチレングリコールモ ノオクタデカン酸エステル、ポリエチレングリコールモ . ノノナデカン酸エステル、ポリエチレングリコールモノ イコサン酸エステル、ポリエチレングリコールモノヘニ コサン酸エステル、ポリエチレングリコールモノドコサ ン酸エステル、ポリエチレングリコールモノトリコサン

とができる。

酸エステル、ポリエチレングリコールモノペンタコサン 酸エステル、ポリエチレングリコールモノヘキサコサン 酸エステル、ポリエチレングリコールモノヘプタコサン 酸エステル、ポリエチレングリコールモノオクタコサン 酸エステル、ポリエチレングリコールモノノナコサン酸 エステル、ポリエチレングリコールモノトリアコンタン 酸エステルなどのポリエチレングリコールアルキル酸エ ステル類およびそのメチルエーテル、エチルエーテル、 プロピルエーテル、トリメトキシシリルエーテル、トリ エトキシシリルエーテル、トリプロポキシシリルエーテ 10 ル、トリメトキシシリルメチルエーテル、トリエトキシ シリルメチルエーテル、2-トリメトキシシリルエチル エーテル、2ートリエトキシシリルエチルエーテル、3 -トリメトキシシリルプロピルエーテル、3-トリエト キシシリルプロピルエーテルなどのポリエチレングリコ ールアルキル酸エステル誘導体などを挙げることができ る。これらのポリエーテルは、1種単独であるいは2種 以上を併用することができる。

【0037】ポリエーテルのGPC法による重量平均分子量は、通常、300~300,000、好ましくは3 200~200,000、特に好ましくは300~100,000である。

【0038】また、(B) 成分を構成するポリエステル としては、炭素数2~12の脂肪族鎖およびエステル結 合を繰り返し単位中に含む化合物を挙げることができ、 例えば、ポリカプロラクトン、ポリピバロラクトン、ポ リエチレンオキサレート、ポリエチレンマロネート、ポ リエチレンスクシネート、ポリエチレングリタレート、 ポリエチレンアジペート、ポリエチレンピメレート、ポ リエチレンスベレート、ポリエチレンアゼラート、ポリ エチレンセバケート、ポリプロピレンオキサレート、ポ リプロピレンマロネート、ポリプロピレンスクシネー ト、ポリプロピレングリタレート、ポリプロピレンアジ ペート、ポリプロピレンピメレート、ポリプロピレンス ベレート、ポリプロピレンアゼラート、ポリプロピレン セバケート、ポリプチレンオキサレート、ポリプチレン マロネート、ポリブチレンスクシネート、ポリブチレン グリタレート、ポリプチレンアジペート、ポリブチレン ピメレート、ポリプチレンスベレート、ポリプチレンア ゼラート、ポリブチレンセバケート、ポリオキシジエチ 40 レンオキサレート、ポリオキシジエチレンマロネート、 ポリオキシジエチレンスクシネート、ポリオキシジエチ レングリタレート、ポリオキシジエチレンアジペート、 ポリオキシジエチレンピメレート、ポリオキシジエチレ ンスベレート、ポリオキシジエチレンアゼラート、ポリ オキシジエチレンセパケートなどの脂肪族ポリエステル 類、およびそのメチルエーテル、エチルエーテル、プロ ピルエーテル、トリメトキシシリルエーテル、トリエト キシシリルエーテル、トリプロポキシシリルエーテル、

ルメチルエーテル、2ートリメトキシシリルエチルエーテル、3ートリエトキシシリルエチルエーテル、3ートリエトキシシリルプロピルエーテル、3ートリエトキシシリルプロピルエーテル、メチルエステル、エチルエステル、プロピルエステル、トリメトキシシリルエステル、トリエトキシシリルエステル、トリプロポキシシリルエステル、トリメトキシシリルメチルエステル、トリエチシシリルメチルエステル、2ートリメトキシシリルエチルエステル、3ートリメトキシシリルプロピルエステル、3ートリエトキシシリルプロピルエステル、3ートリエトキシシリルプロピルエステルなどの脂肪族ポリエステルアルキルエーテル誘導体及び脂肪族ポリエステルアルキルエーテル誘導体及び脂肪族ポリエステルアルキルエステル誘導体が挙げられる。これらのポリエステルは、1種単独であるいは2種以上を併用するこ

【0039】ポリエステルのGPC法による重量平均分子量は、通常、300~300,000、好ましくは300~200,000、特に好ましくは300~100,000である。

【0040】さらに、(B)成分を構成するポリカーボ ネートとしては、繰り返し単位中の炭素数が2~12の 脂肪族ポリカーボネートを挙げることができ、例えば、 ポリエチレンカーボネート、ポリプロピレンカーボネー ト、ポリトリメチレンカーボネート、ポリテトラメチレ ンカーボネート、ポリペンタメチレンカーボネート、ポ リヘキサメチレンカーボネート、ポリヘプタメチレンカ ーボネート、ポリオクタメチレンカーボネート、ポリノ ナメチレンカーボネート、ポリデカメチレンカーボネー ト、ポリオキシジエチレンカーボネート、ポリー3,6 -ジオキシオクタンカーボネート、ポリー3,6,9-トリオキシウンデカンカーボネート、ポリオキシジプロ ピレンカーボネート、ポリシクロペンタンカーボネー ト、ポリシクロヘキサンカーボネートなどの脂肪族ポリ カーボネート、およびそのメチルエステル、エチルエス テル、プロピルエステル、トリメトキシシリルエステ ル、トリエトキシシリルエステル、トリプロポキシシリ ルエステル、トリメトキシシリルメチルエステル、トリ エトキシシリルメチルエステル、2-トリメトキシシリ ルエチルエステル、2-トリエトキシシリルエチルエス テル、3-トリメトキシシリルプロピルエステル、3-トリエトキシシリルプロピルエステルなどの脂肪族ポリ カーボネートアルキルエステル誘導体が挙げられる。こ れらのポリカーボネートは、1種単独であるいは2種以 上を併用することができる。

【0041】ポリカーボネートのGPC法による重量平均分子量は、通常、300~300,000、好ましくは300~200,000、特に好ましくは300~100,000である。

キシシリルエーテル、トリプロポキシシリルエーテル、 【0042】さらに、(B)成分を構成するポリアンハトリメトキシシリルメチルエーテル、トリエトキシシリ 50 イドライドとしては、炭素数2~12の脂肪族ジカルボ

ン酸から得られるポリアンハイドライドが挙げられ、例 えば、ポリオキサリックアンハイドライド、ポリマロニ ックアンハイドライド、ポリスクシニックアンハイドラ イド、ポリグルタリックアンハイドライド、ポリアジピ ックアンハイドライド、ポリピメリックアンハイドライ ド、ポリスベリックアンハイドライド、ポリアゼライッ クアンハイドライド、ポリセバシックアンハイドライド などの脂肪族ポリアンハイドライド、およびそのメチル エステル、エチルエステル、プロピルエステル、トリメ トキシシリルエステル、トリエトキシシリルエステル、 トリプロポキシシリルエステル、トリメトキシシリルメ チルエステル、トリエトキシシリルメチルエステル、2 ートリメトキシシリルエチルエステル、2ートリエトキ シシリルエチルエステル、3-トリメトキシシリルプロ ピルエステル、3-トリエトキシシリルプロピルエステ ルなどの脂肪族ポリアンハイドライドアルキルエステル 誘導体などが挙げられる。これらのポリアンハイドライ ドは、1種単独であるいは2種以上を併用することがで

【0043】ポリアンハイドライドのGPC法による重 20 量平均分子量は、通常、300~300,000、好ま しくは300~200,000、特に好ましくは300 ~100,000である。

【0044】さらに、(B)成分を構成する(メタ)ア クリル系重合体としては、ポリオキシエチル基、ポリオ キシプロピル基、アミド基、ヒドロキシル基、カルボキ シル基の群より選ばれた少なくとも1種を有する(メ タ) アクリル系重合体が挙げられる。上記(メタ) アク リル系重合体は、アクリル酸、メタクリル酸、上記官能 基を有するアクリル酸誘導体、上記官能基を有するメタ 30 クリル酸誘導体、上記官能基を有さないアクリル酸エス テルおよび上記官能基を有さないメタクリル酸エステル より構成される。

【0045】上記官能基を有するアクリル酸誘導体の具 体例としては、2-ヒドロキシエチルアクリレート、ジ エチレングリコールアクリレート、ポリエチレングリコ ールアクリレート、メトキシジエチレングリコールアク リレート、メトキシポリエチレングリコールアクリレー ト、エトギシジエチレングリコールアクリレート、エト キシプロピルアクリレート、ジプロピレングリコールア クリレート、ポリプロピレングリコールアクリレート、 メトキシジプロピレングリコールアクリレート、メトキ シポリプロピレングリコールアクリレート、エトキシジ プロピレングリコールアクリレート、エトキシポリプロ ピレングリコールアクリレート、2-ジメチルアミノエ チルアクリレート、2-ジエチルアミノエチルアクリレ ート、Nービニルピロリドン、ビニルピリジン、アクリ ルアミド、Nーメチルアクリルアミド、N、Nージメチ

リシジルアクリレートなどのモノアクリレート類;ジェ チレングリコールジアクリレート、ポリエチレングリコ ールジアクリレートなどのジアクリレート類;などが挙 げられる。これらは、1種または2種以上を同時に使用 してもよい。

【0046】上記官能基を有するメタクリル酸誘導体の 具体例としては、2-ヒドロキシエチルメタクリレー ト、ジエチレングリコールメタクリレート、ポリエチレ ングリコールメタクリレート、メトキシジエチレングリ 10 コールメタクリレート、メトキシポリエチレングリコー ルメタクリレート、エトキシジエチレングリコールメタ クリレート、エトキシポリエチレングリコールメタクリ レート、2ーヒドロキシプロピルメタクリレート、ジプ ロピレングリコールメタクリレート、ポリプロピレング リコールメタクリレート、メトキシジプロピレングリコ ールメタクリレート、メトキシポリプロピレングリコー ルメタクリレート、エトキシジプロピレングリコールメ タクリレート、エトキシポリプロピレングリコールメタ クリレート、2ージメチルアミノエチルメタクリレー ト、2-ジエチルアミノエチルメタクリレート、メタク リルアミド、Nーメチルメタクリルアミド、N. Nージ メチルメタクリルアミド、Nーメチロールメタクリルア ミド、グリシジルメタクリレートなどのモノメタクリレ ート類;ジエチレングリコールジメタクリレート、ポリ エチレングリコールジメタクリレート、ジプロピレング リコールジメタクリレート、ポリプロピレングリコール ジメタクリレートなどのジメタクリレート類:などが挙 げられる。これらは、1種または2種以上を同時に使用 してもよい。

【0047】上記官能基を有さないアクリル酸エステル の具体例としては、メチルアクリレート、エチルアクリ レート、nープロピルアクリレート、isoープロピル アクリレート、nーブチルアクリレート、isoープチ ルアクリレート、secーブチルアクリレート、ter ープチルアクリレート、アミルアクリレート、ヘキシル アクリレート、ヘプチルアクリレート、オクチルアクリ レート、ノニルアクリレート、デシルアクリレート、ド デシルアクリレート、テトラデシルアクリレート、ヘキ サデシルアクリレート、オクタデシルアクリレート、シ キシポリエチレングリコールアクリレート、2ーヒドロ 40 クロヘキシルアクリレート、2ーエチルヘキシルアクリ レート、2-メトキシエチルアクリレート、2-エトキ シエチルアクリレート、2-メトキシプロピルアクリレ ート、2-エトキシプロピルアクリレート、ベンジルア クリレート、フェニルカルビトールアクリレート、ノニ ルフェニルアクリレート、ノニルフェニルカルビトール、 アクリレート、ジシクロペンテニルオキシエチルアクリ レート、テトラヒドロフルフリルアクリレート、イソボ ルニルアクリレートなどのモノアクリレート類;エチレ ングリコールジアクリレート、1、3-ブチレングリコ ・ルアクリルアミド、N-メチロールアクリルアミド、グ 50 ールジアクリレート、1,4-プチレングリコールジア

クリレート、ネオペンチルグリコールジアクリレート、 1, 6-ヘキサングリコールジアクリレート、2, 2-ビス (4-アクリロキシプロピロキシフェニル) プロパ ン、2,2-ビス(4-アクリロキシジエトキシフェニ ル) プロパンなどのジアクリレート類: トリメチロール エタントリアクリレート、トリメチロールプロパントリ アクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート などのトリアクリレート類;ペンタエリスリトールテト ラアクリレートなどのテトラアクリレート類などが挙げ られる。これらは、1種または2種以上を同時に使用し 10 てもよい。

【0048】上記官能基を有さないメタクリル酸エステ ルの具体例としては、メチルメタクリレート、エチルメ タクリレート、nープロピルメタクリレート、iso-プロピルメタクリレート、nープチルメタクリレート、 isoープチルメタクリレート、secーブチルメタク リレート、terープチルメタクリレート、アミルメタ **クリレート、ヘキシルメタクリレート、ヘプチルメタク** リレート、オクチルメタクリレート、ノニルメタクリレ ート、デシルメタクリレート、ドデシルメタクリレー ト、テトラデシルメタクリレート、ヘキサデシルメタク リレート、オクタデシルメタクリレート、シクロヘキシ ルメタクリレート、2ーエテルヘキシルメタクリレー ト、2-メトキシエチルメタクリレート、2-エトキシ エチルメタクリレート、2-メトキシプロピルメタクリ レート、2-エトキシプロピルメタクリレート、ベンジ ルメタクリレート、フェニルカルビトールメタクリレー ト、ノニルフェニルメタクリレート、ノニルフェニルカ ルビトールメタクリレート、ジシクロペンテニルオキシ エチルメタクリレート、テトラヒドロフルフリルメタク 30 リレート、イソボルニルメタクリレートなどのモノメタ クリレート類:エチレングリコールジメタクリレート、 1, 3-ブチレングリコールジメタクリレート、1, 4 ープチレングリコールジメタクリレート、ネオペンチル グリコールジメタクリレート、1,6-ヘキサングリコ ールジメタクリレート、2,2ービス(4-メタクリロ キシジエトキシフェニル)プロパンなどのジメタクリレ ート類;トリメチロールエタントリエタクリレート、ト リメチロールプロパントリメタクリレートなどのトリメ タクリレート類などが挙げられる。これらは、1種また 40 は2種以上を同時に使用してもよい。

【0049】本発明において、ポリオキシエチル基、ポ . リオキシプロピル基、アミド基、ヒドロキシル基、カル ボキシル基、グリシジル基の群より選ばれた少なくとも 1種を有する (メタ) アクリル系重合体は、アクリル 酸、メタクリル酸、上記官能基を有するアクリル酸誘導 体および上記官能基を有するメタクリル酸誘導体を、上 記 (メタ) アクリレート系重合体を構成する全モノマー に対して通常5モル%以上、好ましくは10モル%以 上、特に好ましくは20モル%以上含む。アクリル酸、

メタクリル酸、上記官能基を有するアクリル酸誘導体お よび上記官能基を有するメタクリル酸誘導体が5モル% 未満の場合は、得られる硬化物塗膜中の空隙のサイズが 大きくなり微細配線間の層間絶縁膜材料として好ましく ない。

【0050】本発明において、(メタ)アクリレート系 重合体は、上記アクリル酸、メタクリル酸、アクリル酸 誘導体およびメタクリル酸誘導体以外のラジカル重合性 モノマーを40モル%以下共重合していてもよい。ラジ カル重合性モノマーとしては、アクリロニトリルなどの 不飽和ニトリル、メチルビニルケトンなどの不飽和ケト ン、スチレン、αーメチルスチレンなどの芳香族化合物 などを挙げることができる。

【0051】本発明において、(メタ)アクリル系重合 体のGPC法による数平均分子量は、1,000~20 0,000、好ましくは1,000~50,000であ る。以上の(B)有機ポリマーは、1種あるいは2種以 上を混合して使用することができる。本発明において上 記(B)成分を用いることで、得られる塗膜の密度を低 下させ、低誘電率を達成することができ、半導体素子な どにおける層間絶縁膜として有用である。(B) 有機ポ リマーの使用量は、(A)成分(完全加水分解縮合物換 算) 100重量部に対し、通常、1~80重量部、好ま しくは5~65重量部である。1重量部未満では、誘電 率を下げる効果が小さく、一方、80重量部を超える と、機械的強度が低下する。ここで、完全加水分解縮合 物とは、化合物 (A-1) ~ (A-2) のSiOR ² 基,SiOR⁴ 基やSiOR⁵ 基が100%加水分解 してSiOH基となり、さらに完全縮合してシロキサン 構造になったものをいう。

【0052】<u>(C) 有機溶媒</u>

本発明に用いられるコーティング組成物は、(A)成分 および(B)成分を、(C)有機溶媒に溶解または分散 してなる。ここで、(C)有機溶媒としては、アルコー ル系溶媒、ケトン系溶媒、アミド系溶媒およびエステル 系溶媒の群から選ばれた少なくとも1種が挙げられる。 このうち、アルコール系溶媒としては、メタノール、エ タノール、nープロパノール、iープロパノール、n-ブタノール、iープタノール、secープタノール、t ープタノール、nーペンタノール、iーペンタノール、 2ーメチルブタノール、secーペンタノール、tーペ ンタノール、3-メトキシブタノール、n-ヘキサノー ル、2-メチルペンタノール、sec-ヘキサノール、 2-エチルプタノール、sec-ヘプタノール、ヘプタ ノール-3、n-オクタノール、2-エチルヘキサノー ル、secーオクタノール、nーノニルアルコール、 2, 6-ii +ii sec-ウンデシルアルコール、トリメチルノニルアル コール、secーテトラデシルアルコール、secーへ 50 プタデシルアルコール、フェノール、シクロヘキサノー

ル、メチルシクロヘキサノール、3,3,5ートリメチ ルシクロヘキサノール、ベンジルアルコール、ジアセト ンアルコールなどのモノアルコール系溶媒;

【0053】エチレングリコール、1,2ープロピレン グリコール、1, 3ープチレングリコール、ペンタンジ オールー2, 4、2ーメチルペンタンジオールー2, 4、ヘキサンジオールー2,5、ヘプタンジオールー 2, 4、2-エチルヘキサンジオール-1, 3、ジエチ レングリコール、ジプロピレングリコール、トリエチレ ングリコール、トリプロピレングリコールなどの多価ア 10 ルコール系溶媒:エチレングリコールモノメチルエーテ ル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレン グリコールモノプロピルエーテル、エチレングリコール モノブチルエーテル、エチレングリコールモノヘキシル エーテル、エチレングリコールモノフェニルエーテル、 エチレングリコールモノー2-エチルブチルエーテル、 ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレン グリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコール モノプロピルエーテル、ジエチレングリコールモノブチ ルエーテル、ジエチレングリコールモノヘキシルエーテ 20 てもよい。 ル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピ レングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコ ルモノプロピルエーテル、プロピレングリコールモノ ブチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエ ーテル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、 ジプロピレングリコールモノプロピルエーテルなどの多 価アルコール部分エーテル系溶媒;などを挙げることが できる。これらのアルコール系溶媒は、1種あるいは2 種以上を同時に使用してもよい。

【0054】これらアルコールのうち、nープロパノー 30 ル、iープロパノール、nーブタノール、iープタノール、secーブタノール、tーブタノール、nーペンタノール、iーペンタノール、2ーメチルブタノール、secーペンタノール、2ーメチルペンタノール、secーヘキサノール、2ーメチルペンタノール、secーヘキサノール、2ーエチルブタノール、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノブロピルエーテル、プロピレングリコールモノブロピルエーテル、プロピレングリコールモノブロピルエーテル、プロピレングリコールモノブロピルエーテル、プロピレングリコールモノブロピルエーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテルなどが好ましい。

【0055】ケトン系溶媒としては、アセトン、メチルエチルケトン、メチルーnープロピルケトン、メチルーnープチルケトン、ジエチルケトン、メチルーiープチルケトン、メチルーnーペンチルケトン、エチルーnープチルケトン、メチルーnーペンチルケトン、ジーiープチルケトン、トリメチルノナノン、シクロヘキサノン、2ーヘキサノン、メチルシクロヘキサノン、2,4ーペンタンジオン、アセトニルアセトン、アセトフェノン、フェンチョンなどのほか、アセチルアセトン、2,4ーヘキサンジオン、2,4ーヘプタンジオン、3,5 50

ーへプタンジオン、2、4ーオクタンジオン、3、5ーオクタンジオン、2、4ーノナンジオン、3、5ーノナンジオン、5ーメチルー2、4ーへキサンジオン、2、2、6、6ーテトラメチルー3、5ーへプタンジオン、1、1、1、5、5、5ーへキサフルオロー2、4ーへプタンジオンなどの β ージケトン類などが挙げられる。これらのケトン系溶媒は、1種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。

【0056】アミド系溶媒としては、ホルムアミド、Nーメチルホルムアミド、N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージエチルホルムアミド、Nーエチルアセトアミド、Nーメチルアセトアミド、Nージメチルアセトアミド、Nーエチルアセトアミド、Nージメチルアセトアミド、Nーエチルアセトアミド、Nージエチルアセトアミド、Nーメチルプロピオンアミド、Nーメチルピロリドン、Nーホルミルピロリジン、Nーホルミルピペリジン、Nーアセチルピロリジンなどが挙げられる。これらアミド系溶媒は、1種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。

【0057】エステル系溶媒としては、ジエチルカーボ ネート、炭酸エチレン、炭酸プロピレン、炭酸ジエチ ル、酢酸メチル、酢酸エチル、ップチロラクトン、ッ ーバレロラクトン、酢酸nープロピル、酢酸iープロピ ル、酢酸n-ブチル、酢酸i-ブチル、酢酸sec-ブ チル、酢酸n-ペンチル、酢酸sec-ペンチル、酢酸 3-メトキシブチル、酢酸メチルペンチル、酢酸2-エ チルブチル、酢酸2-エチルヘキシル、酢酸ベンジル、 酢酸シクロヘキシル、酢酸メチルシクロヘキシル、酢酸 nーノニル、アセト酢酸メチル、アセト酢酸エチル、酢 酸エチレングリコールモノメチルエーテル、酢酸エチレ ングリコールモノエチルエーテル、酢酸ジエチレングリ コールモノメチルエーテル、酢酸ジエチレングリコール モノエチルエーテル、酢酸ジエチレングリコールモノー nーブチルエーテル、酢酸プロピレングリコールモノメ チルエーテル、酢酸プロピレングリコールモノエチルエ ーテル、酢酸プロピレングリコールモノプロピルエーテ ル、酢酸プロピレングリコールモノブチルエーテル、酢 酸ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、酢酸ジ プロピレングリコールモノエチルエーテル、ジ酢酸グリ コール、酢酸メトキシトリグリコール、プロピオン酸エ チル、プロピオン酸n-ブチル、プロピオン酸i-アミ ル、シュウ酸ジエチル、シュウ酸ジーnーブチル、乳酸 メチル、乳酸エチル、乳酸nープチル、乳酸nーアミ ル、マロン酸ジエチル、フタル酸ジメチル、フタル酸ジ エチルなどが挙げられる。これらエステル系溶媒は、1 種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。以上の

(C) 有機溶媒は、1種あるいは2種以上を混合して使用することができる。

【0058】本発明に用いられるコーティング組成物

25

は、上記の(C)有機溶媒を含有するが、(A)成分を構成する化合物(A-1)および(A-2)もしくはいずれか一方を加水分解・縮合する際に、同様の溶媒を使用することができる。

【0059】具体的には、化合物(A-1)および(A-2)もしくはいずれか一方を溶解させた溶媒中に、水または上記(C)有機溶媒中で希釈した水を断続的あるいは連続的に添加する。この際、触媒は、溶媒中に予め添加しておいてもよいし、水添加時に水中に溶解あるいは分散させておいてもよい。この際の反応温度としては、通常、 $0\sim100$ ℃、好ましくは $15\sim90$ ℃である。

【0060】その他の添加剤;本発明に用いられるコー ティング組成物には、さらにコロイド状シリカ、コロイ ド状アルミナ、界面活性剤、pH調整剤などの成分を添 加してもよい。コロイド状シリカとは、例えば、高純度 の無水ケイ酸を上記親水性有機溶媒に分散した分散液で あり、通常、平均粒径が5~30mμ、好ましくは10 ~20mμ、固形分濃度が10~40重量%程度のもの である。このような、コロイド状シリカとしては、例え 20 ば、日産化学工業(株)製、メタノールシリカゾルおよ びイソプロパノールシリカゾル;触媒化成工業(株) 製、オスカルなどが挙げられる。コロイド状アルミナと しては、日産化学工業(株)製のアルミナゾル520、 同100、同200;川研ファインケミカル(株)製の アルミナクリアーゾル、アルミナゾル10、同132な どが挙げられる。界面活性剤としては、例えば、ノニオ ン系界面活性剤、アニオン系界面活性剤、カチオン系界 面活性剤、両性界面活性剤などが挙げられ、さらには、 シリコーン系界面活性剤、ポリアルキレンオキシド系界 30 面活性剤、含フッ素界面活性剤などを挙げることができ る。 p H調整剤としては、有機酸、無機酸、有機塩基、 無機塩基などが挙げられ、具体的には、化合物(Aー 1) , (A-2) の加水分解・縮合の際に用いられる酸 性化合物やアルカリ性化合物と同様の化合物を例示する ことができる。

【0061】組成物の調製方法;本発明に用いられる組成物を調製するに際しては、例えば、(C)有機溶媒中、(A)成分を構成する化合物(A-1)~(A-2)を混合して、水を連続的または断続的に添加して、加水分解し、縮合し、(A)成分を調製したのち、これに(B)成分を添加すればよく、特に限定されない。

【0062】本発明の組成物の調製方法の具体例としては、下記①~④の方法などを挙げることができる。

- ① (A) 成分を構成する化合物 (A-1) ~ (A-2)、および (C) 有機溶媒からなる混合物に、所定量の水を加えて、加水分解・縮合反応を行ったのち、
- (B) 成分を混合する方法。
- ② (A) 成分を構成する化合物 (A-1) \sim (A-2) より、絶縁性、耐熱性に優れた低誘電体膜を形成する際および (C) 成分からなる混合物に、所定量の水を連続 50 に、まず、好ましくは基板を $60\%\sim250\%$ の温度に

的あるいは断続的に添加して、加水分解、縮合反応を行なったのち、(B)成分を混合する方法。

- ③ (A)成分を構成する化合物 (A-1) ~ (A-2)、(B)成分および (C)成分からなる混合物に、 所定量の水を加えて加水分解・縮合反応を行う方法。
- ④(A)成分を構成する化合物(A-1)~(A-
- 2)、(B)成分および(C)成分からなる混合物に、 所定量の水を連続的あるいは断続的に添加して、加水分 解、縮合反応を行なう方法。

【0063】このようにして得られる上記組成物の全固形分濃度は、好ましくは、2~30重量%であり、使用目的に応じて適宜調整される。組成物の全固形分濃度が2~30重量%であると、塗膜の膜厚が適当な範囲となり、保存安定性もより優れるものである。なお、この全固形分濃度の調整は、必要であれば、濃縮あるいは上記(C)有機溶媒による希釈によって行われる。

【0064】このようにして得られる組成物は、必要に応じて、フィルターでろ過したのち、使用することができる。フィルターは、ポリエステル、ポリカーボネート、セルロース、セルロースアセテート、ポリプロピレン、ポリエーテルサルホン、四フッ化エチレン(PTFE)、ポリアミドなどの材質のものを使用することができる。好ましくは、孔径0.05 μ m以下のPTFE製フィルター、特に好ましくは、孔径0.05 μ m以下のPTFE製フィルターを用いることが、組成物中の異物を除去し、得られる塗膜の均一性が優れる点で好ましい。上記のようなフィルターは、材質や孔径の異なるものを組み合わせて使用することができ、また、同一材質や孔径の異なるものを、複数個組み合わせて使用することもできる。

【0065】基板

本発明に用いられる上記組成物を用いて膜を形成するには、まず本発明の組成物を基板に塗布し、塗膜を形成する。ここで、本発明の組成物を塗布することができる基板としては、半導体、ガラス、セラミックス、金属などが挙げられる。また、塗布方法としては、スピンコート、ディッピング、ローラーブレードなどが挙げられる。本発明の組成物は、特にシリコンウエハ、SiO2ウエハ、SiNウエハなどの上に塗布され、絶縁膜とすることに適している。この際の膜厚は、乾燥膜厚として、1回塗りで厚さ $0.05\sim1.5\mu$ m程度、2回塗りでは厚さ $0.1\sim3\mu$ m程度の塗膜を形成することができる。形成する塗膜の厚さは、通常、 $0.2\sim20\mu$ mである。

【0066】 <u>プレベーク、第1次~第2次ソフトベーク、およびファイナルアニール処理</u>

本発明では、(A) ポリシロキサンおよび(B) 有機ポリマーを(C) 有機溶剤に溶解(分散) してなる組成物より、絶縁性、耐熱性に優れた低誘電体膜を形成する際に まず 好ましくは基板を6.0℃~2.5.0℃の温度に

加熱し、基板から有機溶剤を揮発させたのち(プレベーク)、真空または不活性ガス雰囲気下で250~400℃に加熱し(第1次ソフトベーク)、次いで酸素分圧1Pa以上の雰囲気下で250~400℃に加熱し(第2次ソフトベーク)、さらに酸素分圧1Pa未満の雰囲気下で350~470℃に加熱して(ファイナルアニール)、シリカ系膜を得る。

【0067】プレベーク;ここで、塗膜を形成するには、上記(A)~(B)成分を(C)有機溶媒に溶解(分散)してなるコーティング組成物を基板に塗布し、有機溶媒を除去する。この工程を「プレベーク」と呼ぶ。このプレベークに必要な温度は、基板を、好ましくは60℃~250℃、さらに好ましくは70~230℃に加熱するが、このプレベークの温度は、用いられる

(C) 有機溶剤の種類に依存する。60℃未満では、溶剤の蒸発が完全ではなく、ソフトベーク中に溶剤の急激な蒸発が起こる恐れがあり、均一性の良い膜が得られなくなる可能性がある。この際、(C) 有機溶剤の除去に使用する加熱源は、通常、ホットプレートであるが、アンプアニール、オーブン、縦型加熱炉などを用いること 20ができる。有機溶剤の除去に必要な時間は、好ましくは30秒~5分程度であり、この時間は、加熱温度と有機溶剤の種類に依存する。このプレベーク工程では、溶剤の蒸発とともに、一部(A)成分の縮合反応が生じることもある。

【0068】第1次ソフトベーク;この有機溶剤を除去 した塗布膜(以下「塗布膜」ともいう)は、次いで、真 空または不活性ガス雰囲気下で250~400℃、好ま しくは300~390℃の温度にて、好ましくは1分~ 2時間、さらに好ましくは3分~1時間、熱処理される 30 (「第1次ソフトベーク」と呼ぶ)。この第1次ソフト ベーク処理は、上記(B)有機ポリマー成分を分散さ せ、膜を低密度化させるとともに、上記(A)成分の硬 化を促進し、(A)成分に含まれるシラノール基やアル コキシド基などを効率よく相互に結合させ、強靱でかつ 電気絶縁性に優れた膜を形成するのに役立つ。第1次ソ フトベークの際に用いる不活性ガス雰囲気とは、例え ば、窒素やアルゴン、ヘリウムなどである。通常、不活 性ガス雰囲気下での処理は、常圧にて行なわれるが、例 えば1 P a ~ 1 O, 0 O O P a 程度の減圧下で行なうこ 40 とも可能である。

【0069】この第1次ソフトベーク処理を、酸素分圧 1Pa以上の雰囲気下、または250℃未満で行なう と、機械的特性の向上が不充分である。また、第1次ソ フトベーク処理の温度が400℃を超える温度で行なう と、上記(A)成分に含まれるアルキル基などの有機基 が酸化され、酸化された部位がシラノールなどに変化す るなどして吸湿性の高い膜となり、半導体装置に用いら れる絶縁膜として適さない。さらに、第1次ソフトベー ク処理時間が、1分未満では、機械的特性の向上が不充 50

分であり、一方、2時間を超えても、機械的特性の向上があまりない。この第1次ソフトベークに用いられる加熱源は、プレベーク同様、通常、ホットプレートであるが、ランプアニール、オーブン、縦型加熱炉などを用いることができる。この際、加熱装置の部材が十分な耐酸化性を備えている必要がある。

【0070】第2次ソフトベーク;上記第1次ソフトベ ーク処理した塗布膜は、次いで、酸素分圧が1Pa以 上、好ましくは1~19,000Paの雰囲気下で、2 50~400℃、好ましくは300~390℃の温度に て、好ましくは1分~2時間、さらに好ましくは3分~ 1時間、熱処理される(「第2次ソフトベーク」と呼 ぶ)。この第2次ソフトベーク処理は、上記(B)有機 ポリマーの分解残留物を完全に除去し、成膜後の揮発成 分を無くすとともに、(A)成分に含まれるシラノール 基やアルコキシド基などを効率よく相互に結合させ、強 靱でかつ電気絶縁性に優れた膜を形成するのに役立つ。 第2次ソフトベークの際に用いる酸素を含有する雰囲気 とは、例えば空気であり、または、窒素やアルゴン、へ リウムなどの不活性ガスと酸素の混合気体である場合も ある。通常、この処理は、常圧にて行なわれるが、例え ば1 P a ~ 1 0, 0 0 0 P a 程度の減圧下で行なうこと も可能である。

【0071】このソフトベーク処理を、酸素分圧1Pa未満の雰囲気下、または250℃未満で行なうと、機械的特性の向上が不充分である。また、ソフトベーク処理の温度が400℃を超える温度で行なうと、上記(A)成分に含まれるアルキル基などの有機基が酸化され、酸化された部位がシラノールなどに変化するなどして吸湿性の高い膜となり、半導体装置に用いられる絶縁膜として適さない。さらに、ソフトベーク処理時間が、1分未満では、機械的特性の向上が不充分であり、また成膜をの揮発成分が多くなってしまう。一方、2時間を超えても、機械的特性の向上があまりない。このソフトベークに用いられる加熱源は、プレベーク同様、通常、ホットプレートであるが、ランプアニール、オーブン、縦型加熱炉などを用いることができる。この際、加熱装置の部材が十分な耐酸化性を備えている必要がある。

【0072】ファイナルアニール処理;最後に、上記ソフトベーク(第1次~第2次)を終了した塗布膜は、酸素分圧が1Pa未満、好ましくは0~50Paの不活性雰囲気下にて、350~470℃、好ましくは400~450℃、好ましくは1分~3時間の熱処理を行なう(以下「ファイナルアニール」と呼ぶ)。酸素分圧が1Pa未満の不活性雰囲気とは、酸素含量が1,000ppm未満の窒素やアルゴン、ヘリウム、クリプトンなどの不活性気体、または、酸素分圧が1Pa未満の減圧雰囲気である。

【0073】このファイナルアニール処理を、酸素分圧 1Pa以上の雰囲気下で行なうと、上記(A)成分に含

まれるアルキル基などの有機基が酸化されてシラノール 基が生成し、膜が吸湿しやすくなる。その結果、膜が吸 湿すると、膜の誘電率が上昇したり、絶縁特性が劣った 膜となりやすい。このファイナルアニールは、通常、ソ フトベークよりも高い温度、すなわち350℃~470 ℃にて行なわれ、このファイナルアニール処理により、 膜は半導体装置用の絶縁膜に必要な低誘電性、高絶縁 性、高強度の特性を得るに至る。このファイナルアニー ル処理が不十分であった場合、得られた本発明によるシ リカ系膜は、期待どおりの低誘電性、高絶縁性、高強度 10 の特性を得るに至るに至らない。一方、ファイナルアニ ール処理の温度が高すぎると、(A)成分に含まれるア ルキル基などの有機基が分解して、膜密度が高くなり、 誘電率が上昇したりする。さらに、ファイナルアニール 処理時間が、1分未満では、(A)成分の最終的な縮合 度が低くなり、低誘電率を維持できず、一方、3時間を 超えても、機械的強度の向上はあまりない。このファイ ナルアニール処理の加熱源は、ホットプレート、ランプ アニール装置、オーブン、縦型焼成炉などを用いること ができる。

【0074】これらのプレベーク、ソフトベーク、ファ イナルアニール処理は、おのおのの処理において異なる 条件(温度、雰囲気)を複数回行なうステップ処理を行 なっても良い。例えば、プレベークを80℃、1分間行 なったのち、さらに、200℃で3分間行なうなどの方 法が挙げられる。

【0075】このようにして得られる本発明のシリカ系 膜の誘電率は、低誘電率であり、通常、2.6~1. 2、好ましくは2. $5\sim1$. 2、さらに好ましくは2. 4~1.2である。この誘電率は、本発明に用いられる 30 組成物中の(B)成分の含有量により調整することがで きる。なお、本発明のシリカ系膜の炭素含量は、通常、 5~20重量%である。

【0076】また、本発明のシリカ系膜は、高弾性率を 有し、ヤング率が、通常、3~10GPa、好ましくは 4~10GPaである。この弾性率は、本発明に記載の 方法で調製した(A)成分の加水分解縮合物を本発明記 載の方法で焼成することにより得られる。

【0077】さらに、本発明のシリカ系膜は、膜密度 が、通常、0.35~1.25g/cm³、好ましくは 40 0. 4~1. 1g/cm³、さらに好ましくは0. 5~ 1. 0 g/cm³ である。膜密度が 0. 35 g/cm³ 未満では、塗膜の機械的強度が低下し、一方、1.25 g/cm³を超えると、低誘電率が得られない。この膜 密度は、本発明に用いられる組成物中の(B)成分の含 有量により、容易に調整することができる

【0078】さらに、本発明のシリカ系膜は、吸水性が 低い点に特徴を有し、例えば、塗膜を127℃、2.5 a tm、100%RHの環境に1時間放置した場合、放 置後の塗膜のIRスペクトル観察からは参膜への水の吸 50 密度は、膜の膜厚と膜の面積から求めた体積と、膜の重

着は認められない。この低吸水性は、例えば、本発明に おける膜形成用組成物中の化合物 (A-2) の含有量を 本発明に記載の範囲とすることにより得ることができ る。

【0079】本発明のシリカ系膜は、低密度で、絶縁性 に優れ、高弾性率であり、さらに塗布膜の均一性、誘電 率特性、塗膜の耐クラック性、塗膜の表面硬度に優れる ことから、LSI、システムLSI、DRAM、SDR AM、RDRAM、D-RDRAMなどの半導体素子用 層間絶縁膜、半導体素子の表面コート膜などの保護膜、 多層配線基板の層間絶縁膜、液晶表示素子用の保護膜や 絶縁膜などの用途に有用である。また、本発明のシリカ 系膜を有する半導体装置は、金属配線間に本発明の膜を 絶縁膜として有するものである。

[0080]

20

【実施例】以下、本発明を実施例を挙げてさらに具体的 に説明する。ただし、以下の記載は、本発明の態様例を 概括的に示すものであり、特に理由なく、かかる記載に より本発明は限定されるものではない。なお、実施例お よび比較例中の部および%は、特記しない限り、それぞ れ重量部および重量%であることを示している。また、 実施例中では、R²O-基, R⁴O-基およびR⁵O-基を総称して「OR」と略記することがある。さらに、 各種の評価は、次のようにして行なった。

【0081】重量平均分子量

下記条件によるゲルパーミエーションクロマトグラフィ 一 (GPC) (屈折率, 粘度, 光散乱測定) 法により測 定した。

試料溶液:シラン化合物の加水分解縮合物を、固形分濃 度が0.25%となるように、10mMのLiBrを含 むメタノールで希釈し、GPC(屈折率、粘度、光散乱 測定)用試料溶液とした。

装置:東ソー(株)製、GPCシステム モデル GP C - 8020

東ソー (株) 製、カラム Alpha5000/300

ビスコテック社製、粘度検出器および光散乱検出器 モデル Tー60 デュアルメーター

キャリア溶液:10mMのLiBrを含むメタノール キャリア送液速度:1ml/min

カラム温度:40℃

【0082】<u>誘電率</u>

得られた膜に対して蒸着法によりアルミニウム電極パタ ーンを形成させ誘電率測定用サンプルを作成した。該サ ンプルを周波数100kHzの周波数で、横河・ヒュー レットパッカード(株)製、HP16451B電極およ びHP4284AプレシジョンLCRメータを用いてC V法により当該塗膜の誘電率を測定した。

膜密度

31

量から算出した。

弾性率(ヤング率)

得られた膜を、ナノインデンターXP(MST社製)を 用いて、連続剛性測定法により測定した。

【0083】吸水性

得られた<u>塗膜を127℃、2.5atm、100%</u>R H、の環境に1時間放置し、放置後の塗膜のIRスペク トルを観察した。放置前の塗膜のIRスペクトルと比較 して、3, 500 c m⁻¹付近のH₂ O に起因する吸収の 有無を観察し、吸水性を下記基準に従い評価した。 〇:吸収無し

×:吸収有り

【0084】製造例1〔(メタ)アクリル系重合体の合 成〕

100mlフラスコに、メトキシポリエチレングリコー ルメタクリレート20.0g、アゾイソプチロニトリル (AIBN) 0. 33g、2-メルカプトエタノール 0.20gおよび3-メトキシメチルプロピオネート3 Ogを入れ溶解させた。系内を窒素ガスで置換したの ち、80℃のオイルバスで加熱しながら、7時間撹拌す 20 ると粘稠なポリマー溶液が得られた。GPCでポリスチ レン換算の平均分子量を測定すると、数平均分子量が 7,500、重量平均分子量が14,000であった。 【0085】実施例1

(A) 成分の調製; テトラメトキシシシラン101.3 g (完全加水分解縮合物換算:40.0g)、メチルト リメトキシシラン203.0g(完全加水分解縮合物換 算:100.0g)、ジメチルジメトキシシラン97. 3g(完全加水分解縮合物換算:60.0g)、プロピ レングリコールモノプロピルエーテル559.3g、メ 30 チルーn-ペンチルケトン239.7gの混合溶液に、 マレイン酸1. 0g (触媒/SiOR=0.001mo 1比) を水157.7g (H2 O/SiOR=1.0m o1比) に溶かした水溶液を室温で1時間かけて滴下し た。混合物の滴下終了後、さらに60℃で2時間反応さ せたのち、減圧下で全溶液量1,000gとなるまで濃 縮し、固形分含有量20%のポリシロキサンゾルを得 た。

組成物の調製;上記で得たポリシロキサンゾル100g (固形分20g) に、ポリオキシエチレンーポリオキシ 40 プロピレンーポリオキシエチレンブロックコポリマー (三洋化成(株)製、ニューポール62(HO-PEO 5 −PPO30−PEO5 −OH相当)3.5gを添加 し、得られた混合物を8インチシリコンウエハ上にスピ ンコート法により塗布し、プレベークとして、大気中8 0℃で3分間、次いで第1次ソフトベークとして、窒素 下350℃で30分間加熱したのち、さらに第2次ソフ トベークとして、酸素分圧18kPa下、350℃で1 5分間加熱し、さらに真空下42℃で1時間加熱し、無 色透明の膜を形成した。このようにして得られた膜を評 50 して、真空下400℃で1時間加熱し、無色透明の膜を

価した。結果を表1に示す。

【0086】実施例2

(A) 成分の調製;テトラメトキシシシラン101.3 g(完全加水分解縮合物換算:40.0g)、メチルト リメトキシシラン324.7g(完全加水分解縮合物換 算:160.0g)、酢酸プロピレングリコールモノメ チルエーテル183.3g、ジーiープロポキシ・ビス (エチルアセトアセテート) チタン (触媒/SiOR= 0.004mol比) の混合溶液に、水176.8g (H₂ O/SiOR=1.0mol比)を60℃加温下 で1時間かけて滴下した。混合物の滴下終了後、さらに 60℃で2時間反応させたのち、アセチルアセトン10 0.0gを加え、その後、減圧下で全溶液量1,000 gとなるまで濃縮し、固形分含有量20%のポリシロキ サンゾルを得た。

組成物の調製;上記で得たポリシロキサンゾル100g (固形分20g) に、ポリオキシジエチレンアジペート (重量平均分子量:約5,000)3.5gを添加し、 得られた混合物を8インチシリコンウエハ上にスピンコ ート法により塗布し、プレベークとして、大気中80℃ で3分間、次いで窒素下、200℃で90秒、次いで第 1次ソフトベークとして、10Paの減圧下、380℃ で20分間加熱したのち、さらに第2次ソフトベークと して、酸素分圧10Pa下、380℃で15分間加熱 し、次いでファイナルアニール処理として、真空下42 5℃で1時間加熱し、無色透明の膜を形成した。このよ うにして得られた膜を評価した。結果を表1に示す。

【0087】実施例3

(A) 成分の調製;テトラメトキシシシラン152.0 g (完全加水分解縮合物換算:60.0g)、メチルト リメトキシシラン284.1g (完全加水分解縮合物換 算:140.0g)、N, N-ジメチルアセトアミド7 98.8gの混合溶液に、シュウ酸1.0g (触媒/S iOR=0.001mol比)を水157.7g (H2 O/SiOR=1.0mol比) に溶かした水溶液を室 温で1時間かけて滴下した。混合物の滴下終了後、さら に60℃で2時間反応させたのち、減圧下で全溶液量 1,000gとなるまで濃縮し、固形分含有量20%の ポリシロキサンゾルを得た。

組成物の調製;上記で得たポリシロキサンゾル100g (固形分20g) に、ポリヘキサメチレンカーボネート (重量平均分子量:約2,000)8.6gを添加し、 得られた混合物を8インチシリコンウエハ上にスピンコ ート法により塗布し、プレベークとして、大気中80℃ で3分間、次いで窒素下、200℃で60秒、さらに第 1次ソフトベークとして、窒素雰囲気の減圧下(133 Pa)、350℃で30分間加熱したのち、さらに第2 次ソフトベークとして、酸素分圧133Pa下、350 ℃で15分間加熱し、次いでファイナルアニール処理と

形成した。このようにして得られた膜を評価した。結果 を表1に示す。

【0088】実施例4

テトラメトキシシシラン101.3g(完全加水分解縮 合物換算:40.0g)、メチルトリメトキシシラン3 24.7g(完全加水分解縮合物換算:160.0 g)、N, N-ジメチルアセトアミド783.3g、ジ - i - プロポキシ・ビス (エチルアセトアセテート) チ タン(触媒/SiOR=0.004mol比)の混合溶 液に、水176.8g (H₂O/SiOR=1.0mo 10 1比)を60℃加温下で1時間かけて滴下した。混合物 の滴下終了後、さらに60℃で2時間反応させたのち、 アセチルアセトン100.0gを加え、その後、減圧下 で全溶液量1,000gとなるまで濃縮し、固形分含有 量20%のポリシロキサンゾルを得た。

組成物の調製;上記で得たポリシロキサンゾル100g (固形分20g) に、ポリセパシックアンハイドライト (重量平均分子量:約4000) 3.5gを添加し、得 られた混合物を8インチシリコンウエハ上にスピンコー で3分間、次いで第1次ソフトベークとして、1.3P aの窒素雰囲気下、380℃で30分間加熱したのち、 さらに第2次ソフトペークとして、1.3Paの酸素雰 囲気下、380℃で30分間加熱し、さらに真空下、4 50℃で0.5時間加熱し、無色透明の膜を形成した。 このようにして得られた膜を評価した。結果を表1に示 す。

【0089】実施例5

(A) 成分の調製; テトラメトキシシラン101.3 g (完全加水分解縮合物換算:40.0g)、メチルト 30 リメトキシシラン203.0g(完全加水分解縮合物換*

*算:100.0g)、ジメチルジメトキシシラン97. 3g(完全加水分解縮合物換算:60.0g)、プロピ レングリコールモノプロピルエーテル559.3g、メ チルーnーペンチルケトン239.7gの混合溶液に、 マレイン酸1. 0g (触媒/SiOR=0.001mo 1比) を水157.7g (H2O/SiOR=1.0m o 1 比) に溶かした水溶液を室温で1時間かけて滴下し た。混合物の滴下終了後、さらに60℃で2時間反応さ せたのち、減圧下で全溶液量1,000gとなるまで濃 縮し、固形分含有量20%のポリシロキサンゾルを得

組成物の調製;上記で得たポリシロキサンゾル100g (固形分20g) に、製造例1記載の(B)成分3.5 gを添加し、得られた混合物を8インチシリコンウエハ 上にスピンコート法により塗布し、プレベークとして、 大気中80℃で3分間、次いで第1次ソフトベークとし て、窒素下350℃で30分間加熱したのち、さらに第 2次ソフトベークとして、圧力13Paの酸素雰囲気 下、350℃で15分間加熱し、次いで、ファイナルア ト法により塗布し、プレベークとして、大気中180℃ 20 ニール処理として、真空下420℃で1時間加熱し、無 色透明の膜を形成した。このようにして得られた膜を評 価した。結果を表1に示す。

【0090】比較例1

実施例1において、ポリオキシエチレンーポリオキシプ ロピレンーポリオキシエチレンブロックコポリマーを使 用しない以外は、実施例1と同様にして組成物を製造 し、基板に塗布し加熱して、膜を形成した。得られた組 成物および膜の評価を、実施例1と同様にして行った。 結果を表1に示す。

[0091]

【表1】

I			
1	I	比較例	
1			
1	1 1 2	3 4	5 1
1	1		!
誘電率	2.16 2.30	2.10 2.35	2. 25 2. 76
	1		!
膜密度	0.84 0.92	0.85 0.96	0.90 1.26
$ (g/cm^3)$	1	1 1 1	1 1
1			!
弹性率	2.8 3.6	3.1 4.2	3.5 6.2
(GP a)	1		I I
1	11		11
吸水性	1010	10101	0101
	11		

[0092]

【発明の効果】本発明によれば、低密度、低誘電率、低 吸水率で、かつ機械的強度に優れ、半導体素子などにお ける層間絶縁膜材料として有用なシリカ系膜が得られ る。

フロントページの続き

(72)発明者 黒澤 孝彦

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

(72)発明者 山田 欣司

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

Fターム(参考) 4G072 AA28 BB09 CC13 FF01 FF02

FF04 FF09 GG03 HH29 HH30

JJ11 JJ13 JJ47 KK01 KK07

KK09 KK17 LL11 LL13 LL14

LL15 MM01 NN21 PP17 RR05

UU01 UU30

4J038 CG002 DD002 DE002 DF002

DL031 HA236 JA35 JB01

JC13 JC38 KAO6 NAO7 NA11

NA17 NA21 PA19 PB09 PC02

PC03 PC04

5F058 AA04 AA10 AC03 AF04 AG01

AH01 AH02